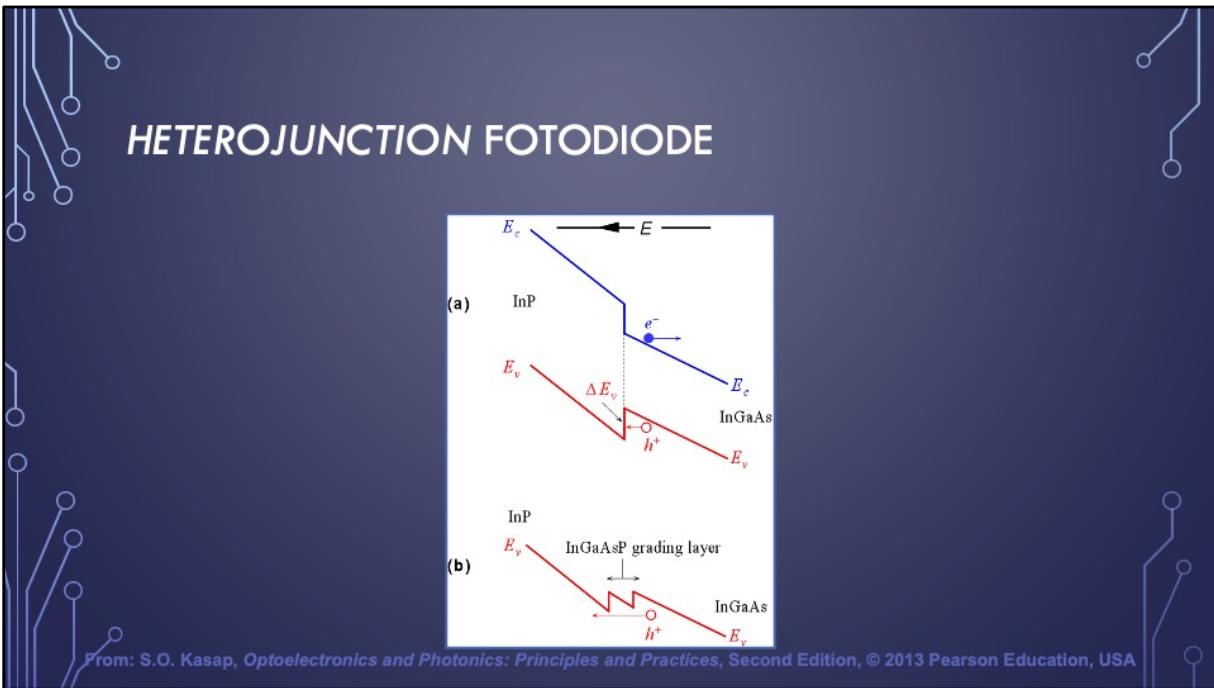
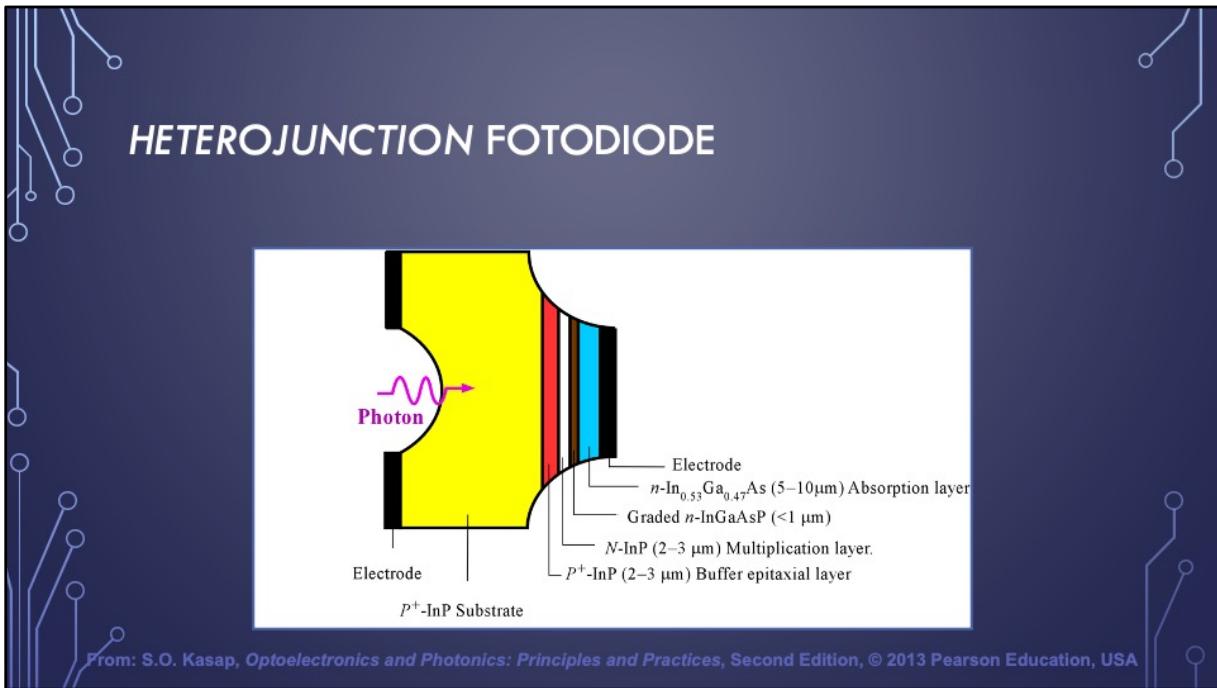


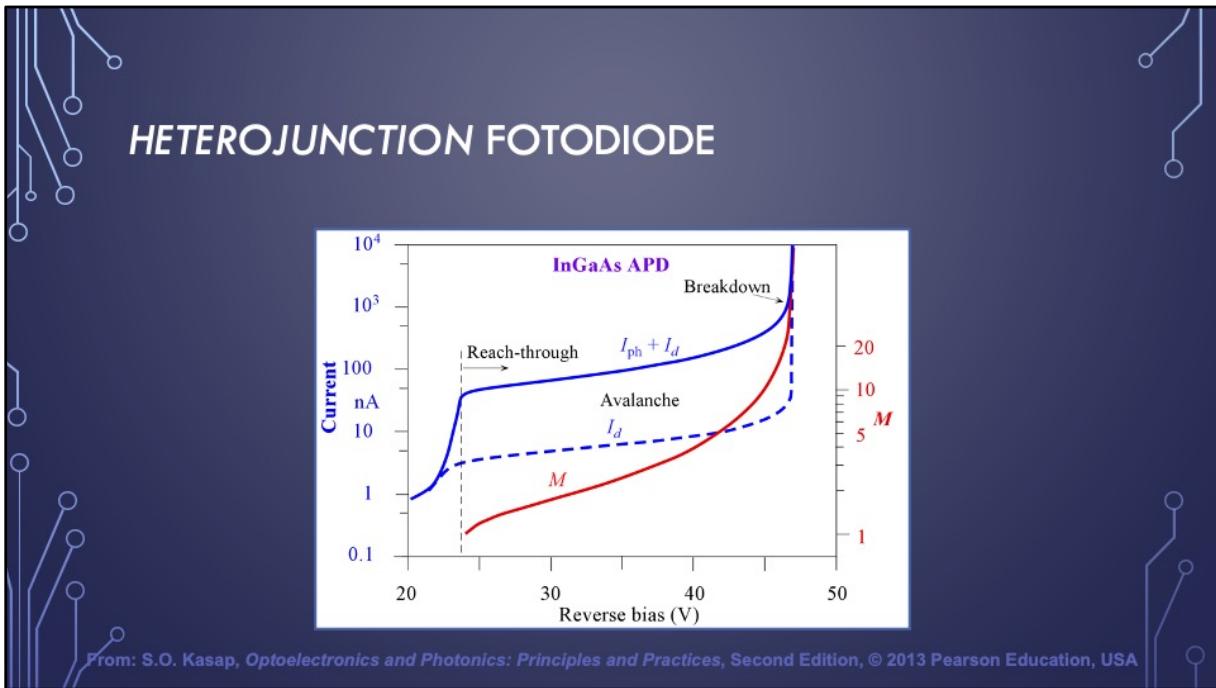
Brojne lavinske fotodiode na bazi jedinjenja elemenata iz III-V grupe su razvijene za talasne dužine koje se koriste u komunikacionim sistemima od  $1.3 \mu\text{m}$  i  $1.55 \mu\text{m}$ . Kao i kod *reach-through* Si APD, regioni za apsorpciju i fotogeneraciju su razdvojeni od lavinskog ili multiplikacionog regiona. Na slici je predstavljena pojednostavljena struktura InGaAs-InP APD sa odvojenim regionima za apsorpciju i multiplikaciju (SAM – *Separate Absorption and Multiplication*). InP ima širi energetski procjep nego InGaAs (*p* i *n* slojevi su označeni velikim slovima P i N). Glavna osiromašena oblast se nalazi između *P<sup>+</sup>* InP i *N* InP slojeva i dominantno se prostire na stranu poluprovodnika *N* InP. Upravo ovdje polje ima najveću jačinu i tu se odvija proces multiplikacije. Ukoliko je dovoljan napon inverzne polarizacije, osiromašena oblast *N* InP se prostire do *n* InGaAs oblasti. Oblast prostornog tovara kod InGaAs se dominantno prostire širinom *n* oblasti. Polje u InGaAs oblasti prostornog tovara nije toliko jako kao kod InP. Grafički prikaz električnog polja po presjeku ove fotodiode je prikazan na slici, prepostavljajući da je primijenjen dovoljan inverzni napon da dode do "reach-through". Iako fotoni dovoljno duge talasne dužine dolaze prema InP strani, nemaju dovoljnu energiju da budu apsorbovani u oblasti prostornog tovara InP. Fotoni prolaze kroz InP slojeve i bivaju apsorbovani u *n* InGaAs sloju. Polje u ovoj oblasti usmjerava šupljine prema InP oblasti gdje se *impact-jonizacijom* vrši multipliciranje nosilaca nanelektrisanja.



Prethodni, veoma pojednostavljen prikaz, ne sadrži veliki broj praktičnih detalja. Fotogenerisane šupljine koje su usmjerene poljem od  $n$  InGaAs prema  $N$  InP postaju zarobljene pri prelazu između poluprovodnika jer postoji nagli porast energetskog procjepa, i nagla promjena energije valentne zone za  $\Delta E_v$  između dva materijala, pa šupljine ne mogu jednostavno prevazići energetsku barijeru  $\Delta E_v$ , kako je prikazano na slici (a). Ovaj problem se prevazilazi upotrebom tankih slojeva poluprovodnika  $n$  tipa InGaAsP čiji se energetski procjepi manje razlikuju, kako bi se omogućio postepen prelaz od InGaAs prema InP, kako je prikazano na slici (b). Energetska barijera  $\Delta E_v$  je "razbijena" na nekoliko nivoa. Šupljine imaju dovoljno energije da prevaziđu prvi korak i dospiju u InGaAsP oblast. Dobijaju dalje ubrzanje da preskoče u sljedeći nivo, itd. Ovakvi uređaji se označavaju kao SAGM (*Separate Absorption, Grading and Multiplication*) APD.

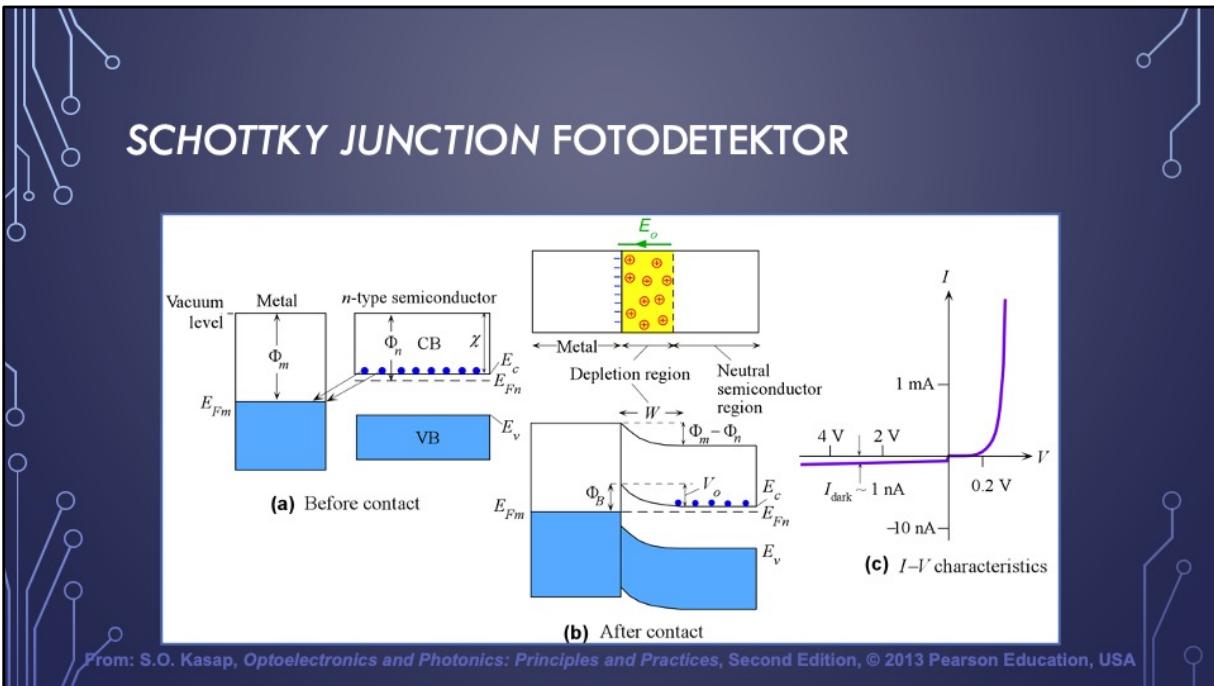


Precizniji šematski prikaz SAGM APD je ilustrovan na slici.



Zavisnost struje od napona inverzne polarizacije za InGaAs *reach-through* APD je data na slici. Optička snaga upadne svjetlosti iznosi 100 nW. Struja fotodiode sadrži *dark* struju  $I_d$  i fotostruju  $I_{ph}$ . *Dark* struja je označena sa  $I_d$ . Ova struja, kao i fotostruja, se pojačava. Inicijalno, osiromašena oblast u  $N$  InP sloju ne pokriva čitav region.

Fotogenerisane šupljine u  $n$  InGaAs sloju moraju difuzijom preći do oblasti prostornog tovara kako bi stigle do polja koje će ih ubrzati. Dakle, kako se napon inverzne polarizacije povećava, fotostruja  $I_{ph}$  i *dark* struja  $I_d$  se povećavaju jer se oblast prostornog tovara širi. Šupljine treba da pređu sve manje i manje rastojanje difuzijom sa povećanjem napona inverzne polarizacije. Struja raste sve dok čitava  $N$  InP oblast ne postane osiromašena. Od tog trenutka, postoji polje u čitavoj  $N$  InP oblasti i fotogenerisane šupljine se usmjeravaju prema  $p^+$  InP regionu. Počinje *impact*-ionizacija i pojačanje  $M$  se povećava sa povećanjem napona inverzne polarizacije, kako je prikazano na slici. Tipično pojačanje  $M$  komercijalnih InGaAs APD iznosi 10-20. Pri dovoljno velikim naponima inverzne polarizacije, može doći do oštećenja uređaja sa naglim porastom struje. Kritični napon se označava kao probojni *breakdown* napon.



Posmatra se slučaj kada je formiran spoj od metala i poluprovodnika  $n$  tipa ( $n$ -SC  $n$ -type Semiconductor). Ovaj spoj se najčešće ostvaruje evaporacijom metala na površinu kristalnog poluprovodnika u vakuumu. Odgovarajući energetski dijagrami su prikazani na slici (a). *Work funkcija*, označena sa  $\Phi$ , je razlika energija između vakuum nivoa i *Fermi* nivoa. Vakuum nivo označava energiju gdje su elektri slobodni i imaju nultu kinetičku energiju.

Prepostavka je da je *work funkcija* metala veća nego u slučaju poluprovodnika,  $\Phi_m > \Phi_n$ . Kada dođe do kontakta dva materijala, energičniji elektri iz provodne zone  $n$ -SC mogu izvršiti "tunelovanje" u metal u potrazi za nižim energetskim nivoima (neposredno iznad  $E_{Fm}$ ) i akumulirati se pri površini metala, kako je prikazano na slici (a). Elektri koji su tunelovanjem napustili  $n$ -SC ostavljaju za sobom osiromašenu oblast širine  $W$  u kojoj sada postoje pozitivni donorski joni, odnosno pozitivni prostorni tovar. Ugrađeni potencijal  $V_0$  se razvija između metala i  $n$ -SC. Očigledno je da sada postoji i ugrađeno električno polje  $E_o$  od pozitivnog prostornog tovara prema elektronima na površini metala, kako je prikazano na slici (b). Ravnoteža je postignuta kada polje dostigne vrijednost koja ne dozvoljava dalju akumulaciju elektrona na površini metala. Situacija je donekle slična  $pn$  spoju. Maksimalna vrijednost električnog polja  $E_o$  je na samom spaju metal -  $n$ -SC.

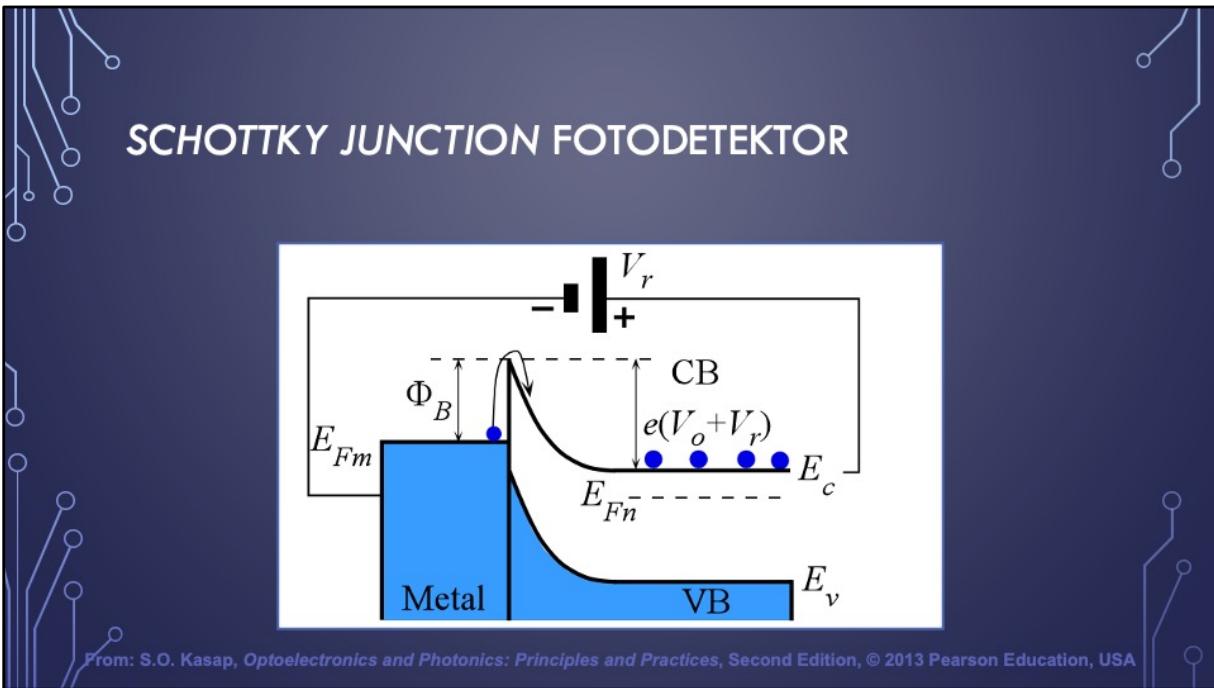
Kada se ostvari kontakt, *Fermi* nivo kroz čitavu strukturu mora biti uniforman i

uravnotežen. Dakle,  $E_{Fm}$  i  $E_{Fn}$  moraju biti "poravnati", kako je prikazano na slici (b). Oblast prostornog tovara je bez slobodnih elektrona, pa u ovoj oblasti razlika  $E_c - E_{Fn}$  mora da se povećava prema spoju, kako koncentracija elektrona opada. Mora doći do "savijanja" zona, kako je prikazano na slici (b). "Savijanje" je toliko da vakuum nivo bude kontinualan i promijeni se za  $\Phi_m - \Phi_n$  od poluprovodnika prema metalu jer je toliko energije potrebno da se elektron prenese od poluprovodnika do metala.

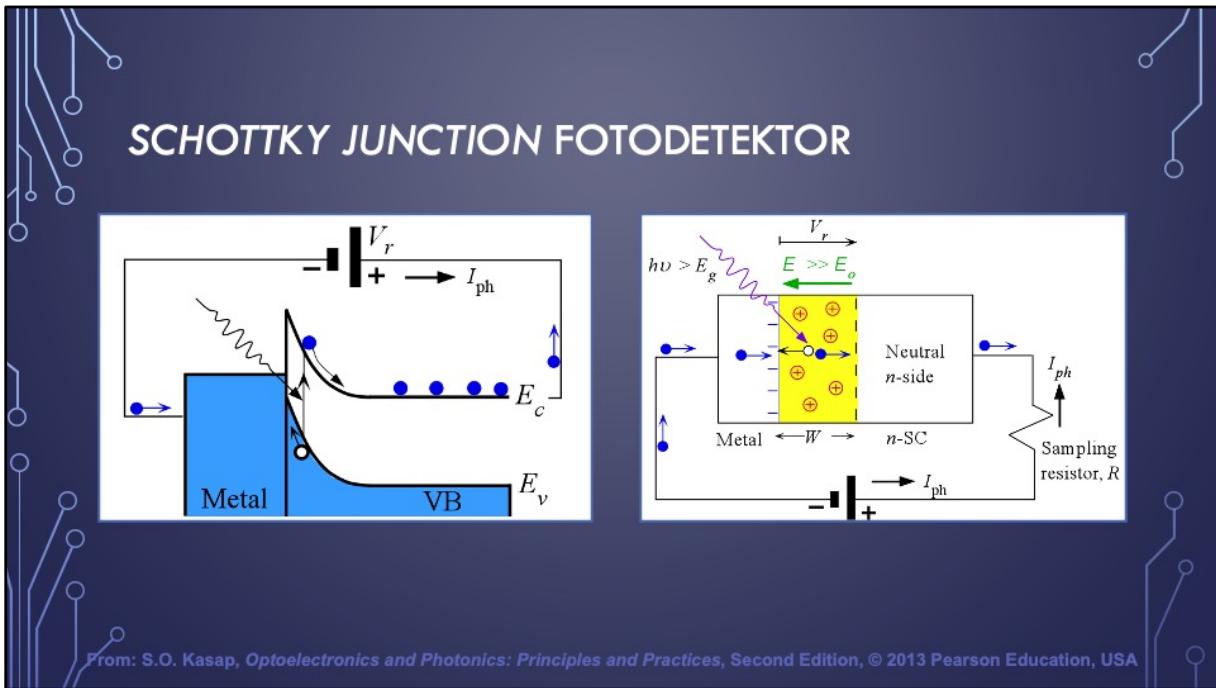
Ugrađena energetska barijera  $eV_0$  je jednaka  $\Phi_m - \Phi_n$ . Upravo ova energija odgovara "savijanju" zona, odnosno, promjeni  $E_{Fn}$  kako bi se poravnao sa  $E_{Fm}$ .

Energetska barijera za elektrone koji se kreću od metala prema poluprovodniku označava se kao *Schottky barrier height*,  $\Phi_B$ , i veća je od  $eV_0$ .

I-V karakteristika Schottky spoja je data na slici (c), i veoma je slična karakteristici *pn* spoja. Kako je očigledno sa slike (b), barijera koja se suprotstavlja ubrizgavanju elektrona od *n*-SC prema metalu iznosi  $eV_0$ . Barijera koja se suprotstavlja ubrizgavanju elektrona od metala prema *n*-SC iznosi  $\Phi_B$ . U ravnoteži, brzine ubrizgavanja elektrona u suprotnim smjerovima (koje po eksponencijalnom zakonu zavise od energetske barijere) su male i balansiraju se. Pri direktnoj polarizaciji naponom  $V$ , sa pozitivnim terminalom vezanim za metal i negativnim za *n*-SC, dolazi do redukcije napona na  $V_0 - V$ . Kako je brzina ubrizgavanja elektrona proporcionalna  $\exp[-e(V_0 - V)/k_B T]$ , dolazi do povećanja ove brzine  $\exp[eV/k_B T]$  puta, što zapravo znači veoma veliku brzinu ubrizgavanja elektrona sa *n*-SC strane prema metalu. Direktna struja je dakle veoma velika i zavisi eksponencijalno od napona direktne polarizacije  $V$ .



Ukoliko se primjeni inverzna polarizacija naponom  $V_r$ , napon  $V_o$  raste na  $V_o + V_r$ . Brzina ubrizgavanja elektrona sa  $n$ -SC strane prema metalu postaje veoma mala, i prevazilazi je mala brzina ubrizgavanja elektrona od metala prema  $n$ -SC "preko  $\Phi_B$ " koja je proporcionalna  $\exp(-\Phi_B/k_B T)$ .



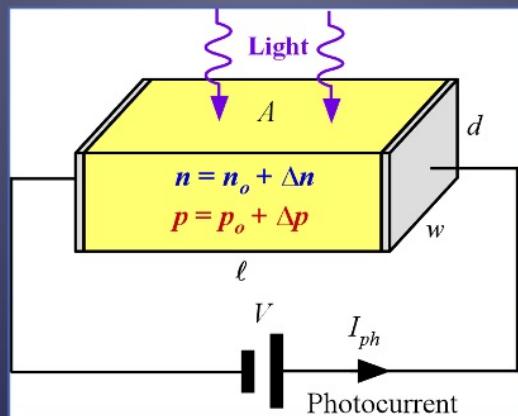
Kao fotodioda, *Schottky* spoj (SJ) je inverzno polarisan kako bi se ostvarilo jako polje u oblasti prostornog tovara. Ukoliko se osiromašena oblast SJ-a osvijetli fotonima energije veće od  $E_g$ , ostvariće se fotogeneracija u oblasti prostornog tovara. Elektroni i šupljine će se “spustiti” niz odgovarajući energetski spust, kako je prikazano na slici lijevo. Oni vrše *drift* u odgovarajućem smjeru, kako je prikazano na slici desno. Za foton čija energija je manja od  $E_g$ , uređaj će ipak odgovoriti, ukoliko energija fotona može pobuditi elektron iz  $E_{Fm}$  metala “preko  $\Phi_B$ ” do provodne zone, odakle će se elektron “spustiti” prema neutralnom *n* regionu. U ovom slučaju energija fotona  $h\nu > \Phi_B$ . SJ fotodioda može raditi u fotonaponskom modu, bez primjene polarizacije, jer ugrađeno polje  $E_o$  može razdvojiti i usmjeriti fotogenerisane nosioce nanelektrisanja u oblasti prostornog tovara.

**Značajna prednost** SJ fotodioda je ta što je oblast prostornog tovara odmah pored metalnog kontakta. Svjetlost male talasne dužine bi bila apsorbovana u neutralnoj oblasti u blizini elektrode kod *pn* ili *pin* fotodioda, dok je kod SJ fotodiode apsorbovana u oblasti prostornog tovara. Generisani parovi elektron-šupljine se mogu trenutno razdvojiti, usmjeriti i prikupiti, dok manjinski nosioci nanelektrisanja moraju difuzijom stići do oblasti prostornog tovara kod *pn* ili *pin* fotodioda. Osim toga, kod *pn* i *pin* fotodioda, mnogi fotogenerisani nosioci nanelektrisanja difuzijom dospiju do površine gdje se rekombinuju.

Očigledno je da su SJ fotodiode pogodne za detektovanje svjetlosti male talasne dužine, pa se koriste često kao UV detektori. SJ diode imaju široku spektralnu osjetljivost, od UV do crvene svjetlosti.

Još jedna prednost SJ fotodetektora je ta što mogu biti značajno brži od *pn* ili *pin* fotodioda. Ubrizgani nosioci nanelektrisanja su elektroni koji su većinski nosioci nanelektrisanja, pa ih ne usporava rekombinaciono vrijeme karakteristično za manjinske nosioce nanelektrisanja.

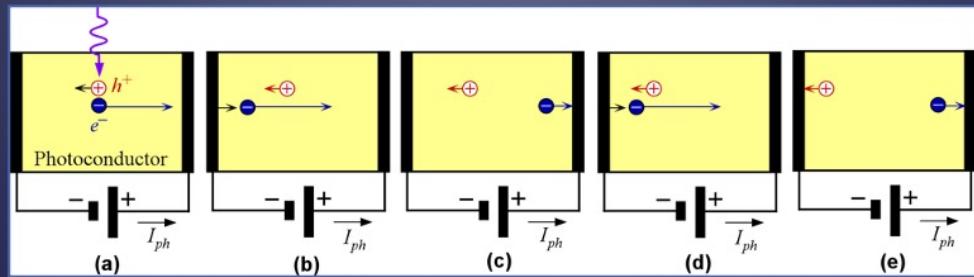
## FOTOKONDUKTIVNI DETEKTORI I FOTOKONDUKTIVNO POJAČANJE



From: S.O. Kasap, *Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices*, Second Edition, © 2013 Pearson Education, USA

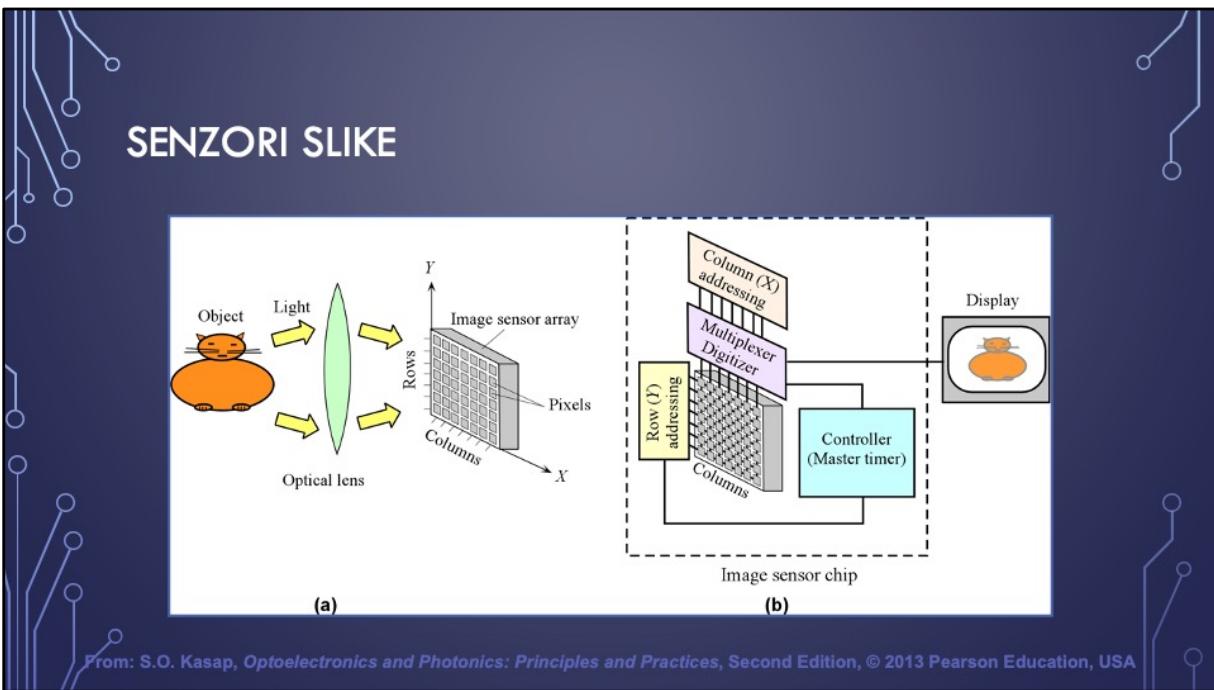
Fotokonduktivni detektori imaju jednostavnu strukturu kako je prikazano na slici. Poluprovodnik odgovarajuće kvantne efikasnosti i koeficijenta apsorpcije za odgovarajući opseg talasnih dužina je između dvije elektrode. Na elektrode se dovodi polarizacioni napon. Po apsorpciji upadnih fotona dolazi do fotogeneracije parova elektron-šupljina. Rezultat je povećana provodnost poluprovodnika, a samim tim i porast eksterne struje koja čini fotosruju  $I_{ph}$ , kako je prikazano na slici.

## FOTOKONDUKTIVNI DETEKTORI I FOTOKONDUKTIVNO POJAČANJE



Sa omskim kontaktima, fotoprovodnik ostvaruje fotokonduktivno pojačanje, odnosno, eksterna struja je rezultat generisanja više od jednog elektrona po apsorbovanom fotonu, kako je prikazano na slici.

Apsorbovani foton fotogeneriše par elektron-šupljina, koji *drift*-uju u suprotnim smjerovima kako je prikazano na slici (a). Elektron se kreće mnogo brže od šupljine i veoma brzo napušta uzorak. Uzorak, međutim, mora biti električno neutralan, što znači da drugi elektron mora ući u uzorak sa negativne elektrode, slika (b). Novi elektron veoma brzo napušta uzorak, dok se šupljina još uvijek polako kreće prema negativnoj elektrodi, slike (b) i (c). Sada još jedan elektron mora ući u uzorak kako bi se održala neutralnost, slike (d) i (e), itd. sve dok šupljina ne stigne do negativne elektrode ili se rekombinuje sa jednim od elektrona u uzorku. Eksterna fotostruja, dakle, odgovara toku mnogih elektrona po apsorbovanom fotonu što predstavlja pojačanje koje se označava kao fotokonduktivno pojačanje. Pojačanje zavisi od vremena *drift*-a nosilaca nanelektrisanja i njihove "dužine života" (do rekombinacije).



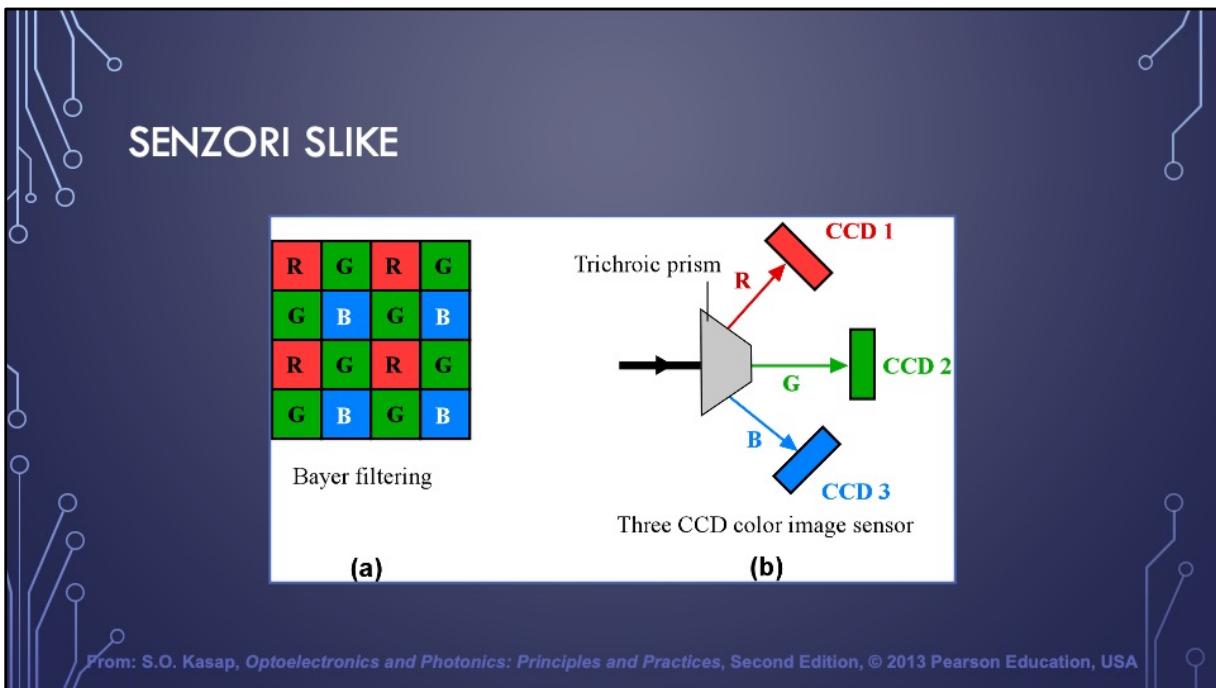
Senzor slike, kako je prikazano na slici (a), je integrисано коло које се састоји од низа fotoosjetljivih елемената, које је у стању да сними слику и да обезбједи излаз у форми електричног сигнала као што је напон, струја или наелектришење. Излаз се обично преузима преко мултеплексера који праће AD конвертор да би се добио дигитални формат слике како је приказано на slici (b). Сензор се обично састоји од матице елемената слике – пиксела (*picture element*). Сваки пиксел поседује детектор и у стању је да обезбједи електрички сигнал који је пропорционалан интензитету светlosti детектованом на том месту. Соčivo формира слику објекта на сензору слике, и светlost интензитета  $I(X,Y)$  за сваку тачку слике (на самом сензору) побудује одговарајући пиксел на  $X,Y$  локацији. Таčka слике  $X,Y$  побудује пиксел  $(i,j)$  и пиксел на позицији  $(i,j)$  дaje електрички сигнал пропорционалан интензитету светlosti  $I(X,Y)$ . Dakle, сваки пиксел  $(i,j)$  носи дио информације слике.

Senzorski niz приказан на slici (b) се адресира од стране контролера (*Master timer*) како би се прочитали сигнали (наелектришење) пиксела и добила електронски снимљена слика. Postoje dvije osnovne *solid-state* tehnologije које се односе на сензоре слике, а то су:

**CCD (Charge-Coupled Device) сензори**

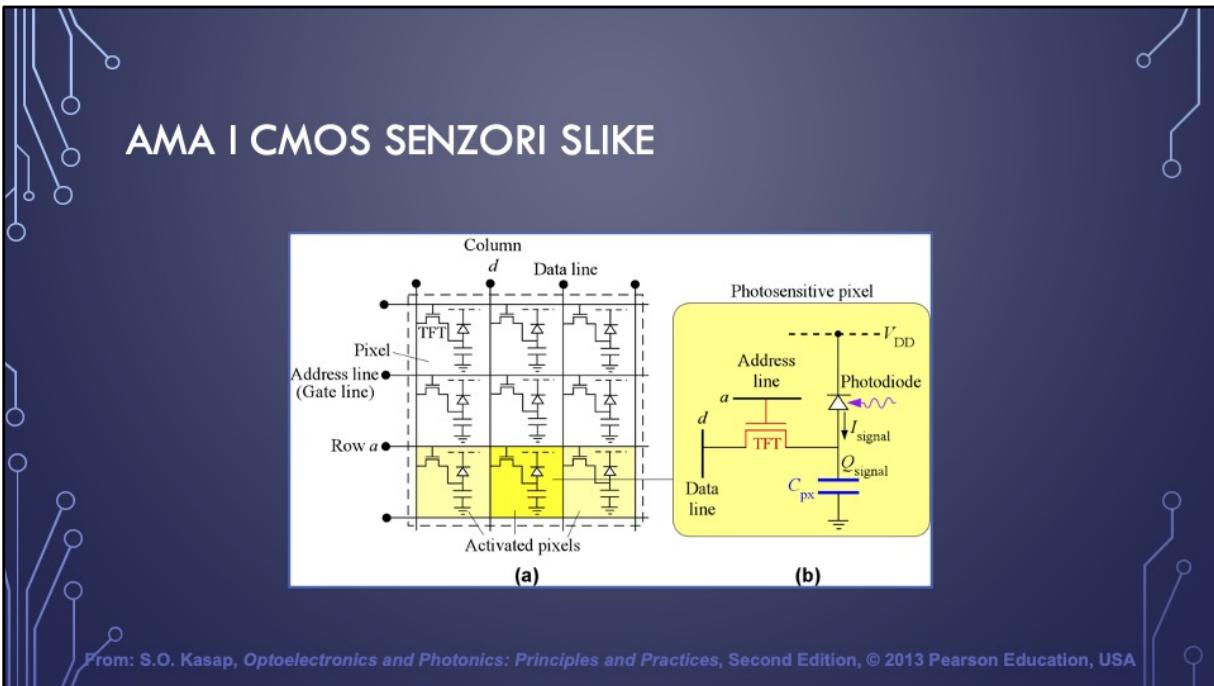
**CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) сензори**

CMOS ukazuje na tehnologiju koja se koristi za proizvodnju senzora. Kod CCD tehnologije, upadna svjetlost (za odgovarajući piksel) generiše naelektrisanje koje je smješteno u CCD pikselu (koji se označava kao *well*). Ovo naelektrisanje (električni signal) se iščitava sekvencijalnim taktnim mehanizmom, koji se svodi na šiftovanje naelektrisanja prema registru za konačno iščitavanje. CMOS senzor je više senzor slike kakav je prikazan na slici (b). Svaki piksel sadrži MOSFET i fotodiodu. Električni signali se iščitavaju red po red. Red *i* se adresira od strane kontrolera, i svi pikseli u ovom redu obezbjeđuju odgovarajući signal. Paralelni podaci se multipleksiraju i digitalizuju kako bi se dobila digitalna slika. Senzor slike kvantizuje sliku u  $M \times N$  piksela, što predstavlja njenu rezoluciju.



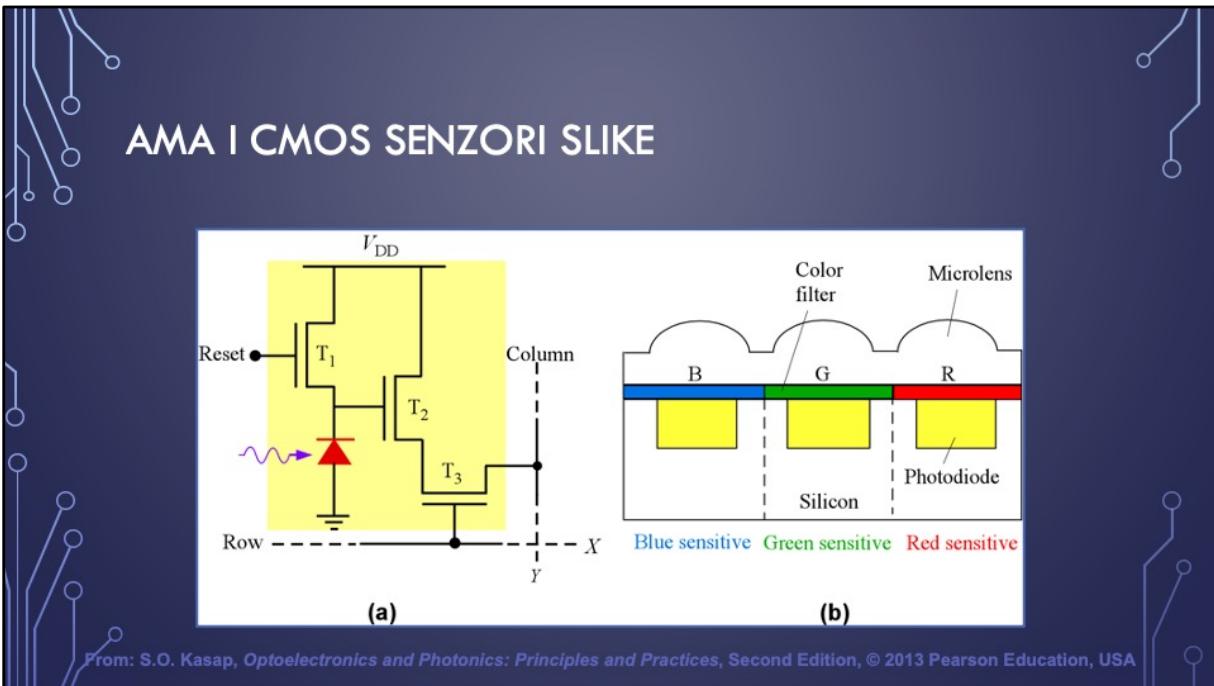
*Color rendering* uz pomoć senzora slike se može izvršiti na tri načina. Najčešći pristup je upotreba crvenog, zelenog i plavog filtera za razdvajanje boja u tački na tri različita susjedna piksela, kao u slučaju *Bayer color* senzora slike, slika (a). Svaki fotodetektor prikuplja informaciju o jednoj boji, a ostale boje se izračunavaju na osnovu vrijednosti susjednih piksela. Na ovaj način se gubi na oštrini slike. Kod *Three CCD* senzora slike, slika (b), trihroična prizma se koristi za razdvajanje svjetlosti od objekta na crvenu, zelenu i plavu i tri različita CCD-a se koriste da detektuju svaku od komponenti. Treća tehnika koristi različite apsorpcione dubine silicijuma za crvenu, zelenu i plavu svjetlost. Crvena, zelena i plava svjetlost imaju različite dubine penetracije, tako da se mogu koristiti odgovarajuće fotodiode kako bi se razdvojile tri osnovne boje. *Bayer* filtriranje je tehnika koja se najčešće koristi kod *color* senzora slike.

Pored boja, za vjernu reprodukciju slike su potrebne i informacije o količini svjetlosti. Za svaku od tri boje, intenzitet svjetlosti se dijeli na 256 nivoa. Ova kombinacija od  $256 \times 256 \times 256$  daje 16.7 miliona mogućih nijansi.



Mnogi senzori slike, kao i različite *flat panel* TV tehnologije koriste AMA (**Active Matrix Arrays**). AMA je dvodimenzionalni niz piksela kod kojih svaki piksel posjeduje *thin film* tranzistor koji se eksterno može adresirati u cilju iščitavanja signala na izlazu senzora na poziciji datog piksela. U zavisnosti od primjene, aktivna matrica može sadržati od svega nekoliko piksela pa do nekoliko miliona piksela. TFT AMA tehnologiju je prvobitno razvio Peter Brody-a još 1970. Pojednostavljeni dijagram je prikazan na slici (a), dok je na slici (b) prikazan jedan piksel. Svaki piksel, osim tranzistora, sadrži fotodiodu i kondenzator kapacitivnosti  $C_{px}$ . Kada piksel prihvati svjetlost od određene tačke osvijetljenog objekta, fotodioda generiše struju  $I_{signal}$  kojom se puni kondenzator  $C_{px}$ . Signal predstavlja nanelektrisanje  $Q_{signal}$  skladišteno u kondenzatoru  $C_{px}$ . AMA, dakle, čuva sliku kao nanelektrisanje kondenzatora. Potrebno je samo izvršiti "očitavanje" nanelektrisanja.

Svaki piksel sadrži TFT čiji je *gate* povezan na određenu adresnu liniju, dok mu je *source* vezan za odgovarajuću *data* liniju, slika (b). Kada se adresira red  $a$ , vrši se očitavanje svakog piksela odnosno nanelektrisanja sa kondenzatora  $C_{px}$  u okviru svakog piksela u redu  $a$ . Podaci se paralelno očitavaju. Moguće je skenirati sliku, red po red, počevši od vrha, sekvencijalno aktivirajući red po red. Dakle, svaki put kada se pristupi odgovarajućem redu, podaci o svakom pikselu (nanelektrisanje  $Q_{signal}$  na kondenzatoru  $C_{px}$ ) iz posmatranog reda se dobijaju paralelno.

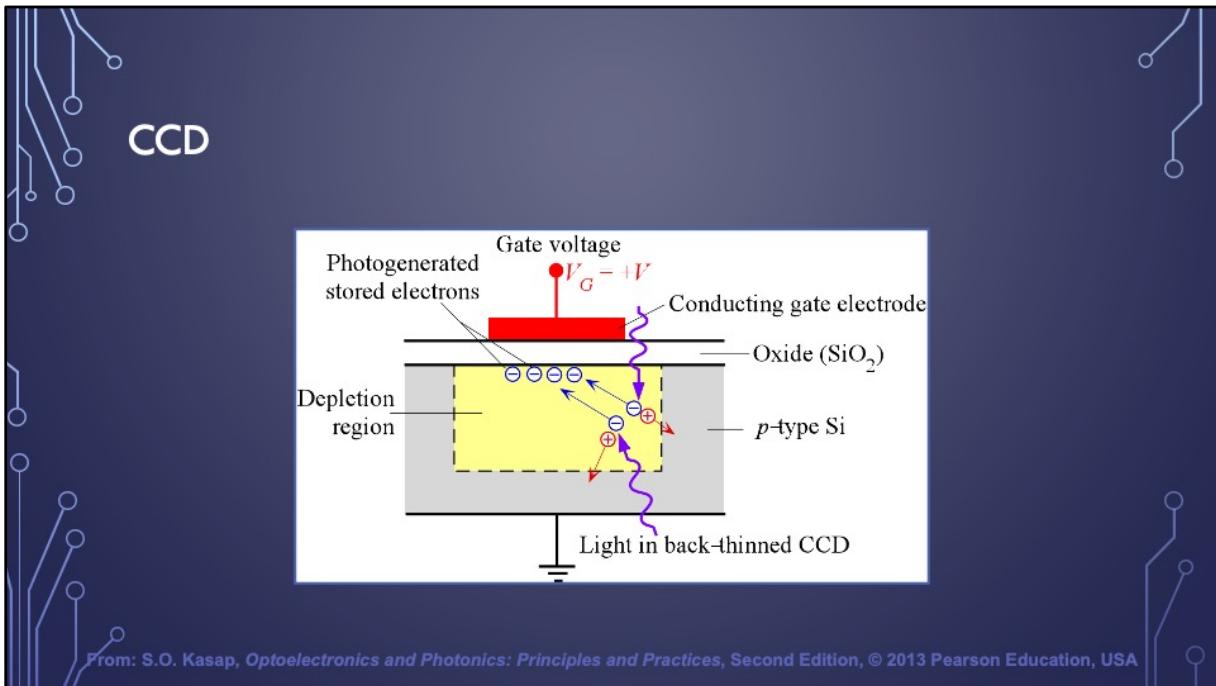


CMOS senzor slike je u suštini AMA kod koga svaki piksel sadrži fotodiodu i jedan ili više MOSFET-ova za iščitavanje i pojačavanje električnog signala koji je generisan pod uticajem upadne svjetlosti. Postupak očitavanja je isti kao kod AMA senzora.

Arhitektura piksela se razlikuje u zavisnosti od primjene.

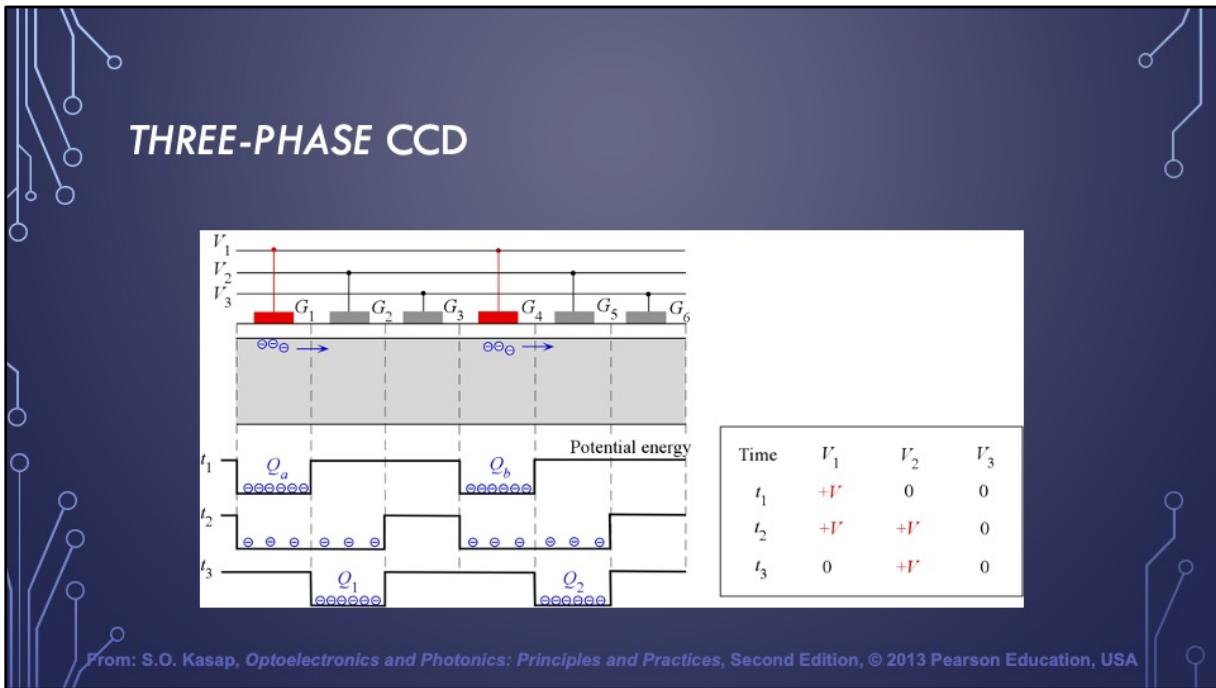
Kako je CMOS veoma zastupljena tehnologija, CMOS senzori slike se relativno jeftino mogu proizvoditi. Ukoliko je piksel aktivni (sa aktivnom komponentom), senzor se označava kao aktivni piksel senzor slike. Gotovo svi savremeni CMOS senzori slike su aktivni. Jedna moguća arhitektura aktivnog piksela sa fotodiodom je prikazana na slici (a).  $T_1$  je *reset* tranzistor,  $T_2$  je *source-follower (buffer)*, dok je  $T_3$  prekidački tranzistor. Kada je  $T_1$  zakočen, fotostruja puni parazitnu kapacitivnost fotodiode do određenog nivoa napona. Kada red  $X$  dobije signal,  $T_3$  provodi i naponski signal sa fotodiode se preko *buffer-a*  $T_2$  prenosi na kolonu  $Y$ . Piksel se potom resetuje,  $T_1$  povezuje fotodiodu na  $V_{DD}$  kako bi se ispraznilo nagomilano nanelektrisanje.

CMOS senzori slike imaju veliki broj prednosti. Standardna CMOS tehnologija omogućava integraciju kamera na čipu. Kamera na čipu sadrži mikrosočiva za svaki piksel, crveni, zeleni i plavi filter za svaki piksel (za slučaj *color imaging-a*), kako je prikazano na slici (b), analogno procesiranje signala i AD konverziju. Arhitektura na bazi aktivnih piksela može sadržati pojačavački stepen kako bi se povećala cijelokupna efikasnost.

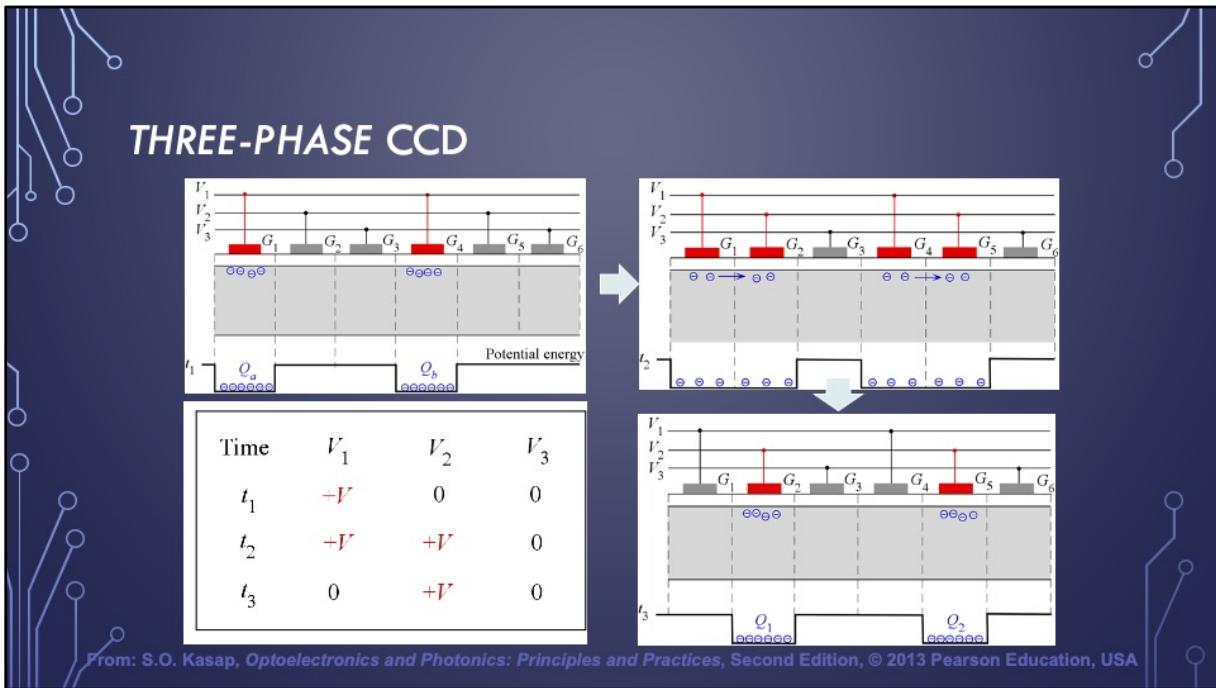


CCD su senzori koji se najčešće koriste kod profesionalnih TV kamera i kao senzori slike digitalnih *still* kamera. Međutim, termin CCD generalno ne ukazuje na senzor slike već na čip koji je u mogućnosti da skladišti i prenese signal u formi nanelektrisanja. CCD čip je integrисано коло које садржи велики број пиксела. Основни градивни елемент овог кола је MOS или MIS уређај, слика. Метална електрода је често прозирна за светлост. Парови електрон-шупљине се генеришу у области просторног творца, под утицајем светlosti која се усмерава са горње или доње стране уређаја. CCD код којих се освjetljavanje врши са доње стране уређаја имају танji *p* слој (подлогу).

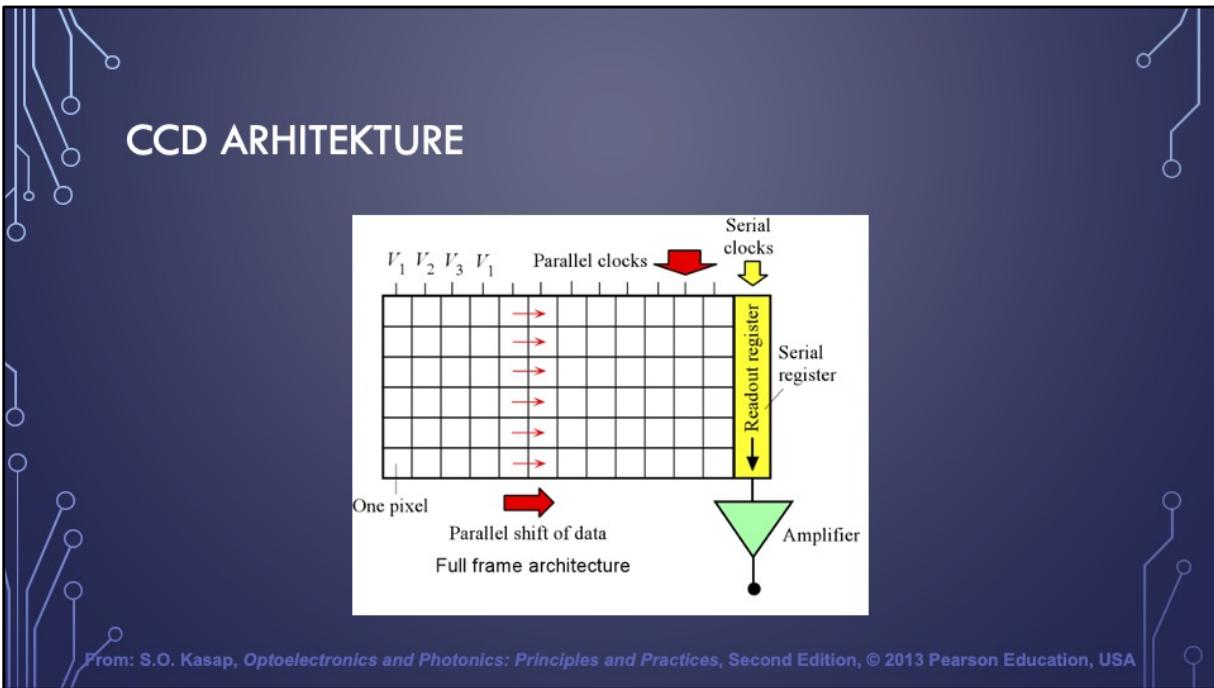
Kada се примјеније позитивни напон на гејт  $V_G=+V$ , фотогенерисани електрони у осиromašеној области се прикупљају испод слоја оксида, слика. Укупно нанеlektrisanje ових електрона је пропорционално интензитету упадне светlosti. Управо ово нанеlektrisanje чини електрични сигнал који носи информацију. Циљ је очитати нанеlektrisanje освjetljenih пиксела.



Kod **three-phase CCD**, postoje tri naponske linije  $V_1$ ,  $V_2$  i  $V_3$  za koje se povezuju gejtovi na sljedeći način:  $G_1$  na  $V_1$ ,  $G_2$  na  $V_2$ ,  $G_3$  na  $V_3$ ,  $G_4$  na  $V_1$  i tako dalje, slika.  $V_1$ ,  $V_2$  i  $V_3$  su taktovani na odgovarajući način tako da pomjeraju naelektrisanje od piksela do piksela prema registru koji se nalazi na kraju. Ukoliko je u trenutku  $t = t_1$ ,  $V_1 = +V$ , dok su  $V_2 = V_3 = 0$ , fotogenerisano naelektrisanje će biti smješteno ispod gejtova  $G_1$ ,  $G_4$  itd. kao  $Q_a$ ,  $Q_b$ , itd. Ukoliko je u narednom trenutku  $t = t_2$ ,  $V_1 = +V$ ,  $V_2 = +V$ , dok je  $V_3 = 0$ , naelektrisanje  $Q_a$  se dijeli između well-ova ispod gejtova  $G_1$  i  $G_2$ . Ukoliko je u narednom trenutku  $t = t_3$ ,  $V_1 = 0$ ,  $V_2 = +V$ , dok je  $V_3 = 0$ , naelektrisanje  $Q_a$  je skoncentrisano ispod gejta  $G_2$ . Dakle, promjenom napona na gejtu, naelektrisanje  $Q_a$  se pomjera od gejta  $G_1$  prema gejtu  $G_2$ , i slično  $Q_b$  se pomjera od gejta  $G_4$  prema gejtu  $G_5$  i tako dalje. Naelektrisanje se, dakle, progresivno taktuje preko gejtova, od piksela do piksela, dok se ne stigne do samog kraja niza gdje se nalazi registar. CCD iščitavanje funkcioniše kao *shift* registar kod koga takt impulsi pomjeraju informaciju duž lanca. Upravo iz ovog razloga, ova kola se označavaju i kao CCD *shift* registri.



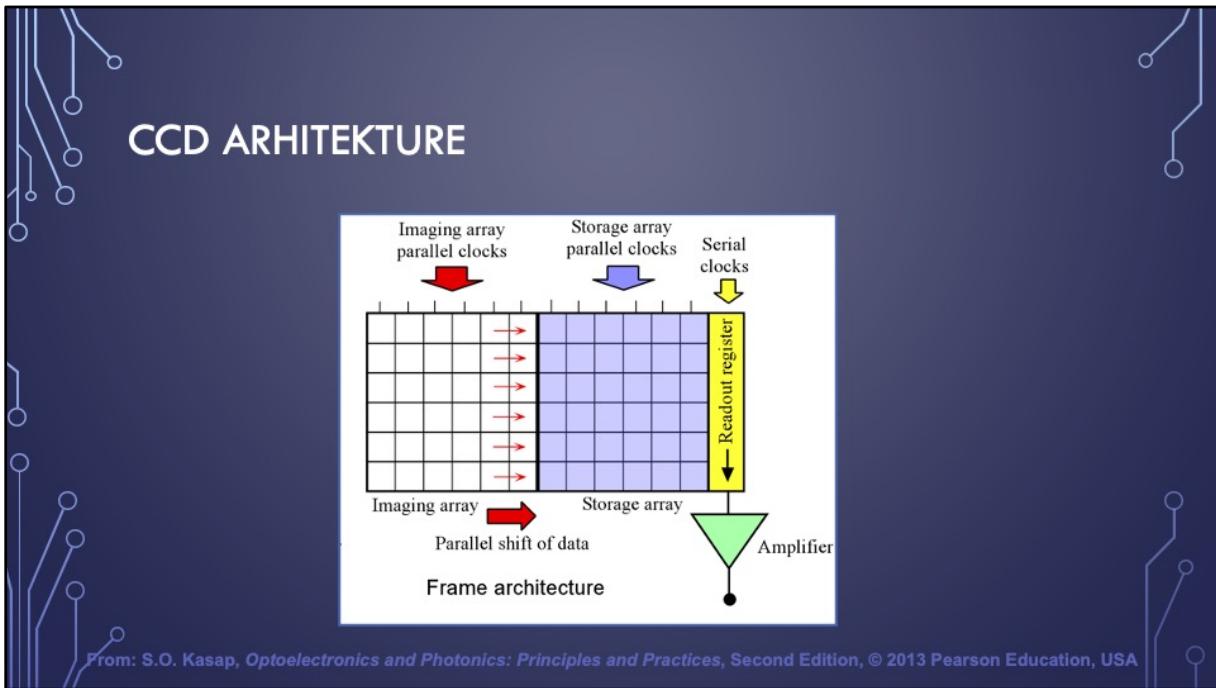
Ukoliko je u trenutku  $t = t_1$ ,  $V_1 = +V$ , dok su  $V_2 = V_3 = 0$ , fotogenerisano naelektrisanje će biti smješteno ispod gejtova  $G_1$ ,  $G_4$  itd. kao  $Q_a$ ,  $Q_b$ , itd. Ukoliko je u narednom trenutku  $t = t_2$ ,  $V_1 = +V$ ,  $V_2 = +V$ , dok je  $V_3 = 0$ , naelektrisanje  $Q_a$  se dijeli između well-ova ispod gejtova  $G_1$  i  $G_2$ . Ukoliko je u narednom trenutku  $t = t_3$ ,  $V_1 = 0$ ,  $V_2 = +V$ , dok je  $V_3 = 0$ , naelektrisanje  $Q_a$  je skoncentrisano ispod gejta  $G_2$ . Dakle, promjenom napona na gejtu, naelektrisanje  $Q_a$  se pomjera od gejta  $G_1$  prema gejtu  $G_2$ , i slično  $Q_b$  se pomjera od gejta  $G_4$  prema gejtu  $G_5$  i tako dalje. Naelektrisanje se, dakle, progresivno taktuje preko gejtova, od piksela do piksela, dok se ne stigne do samog kraja niza gdje se nalazi registar. CCD iščitavanje funkcioniše kao *shift* registar kod koga takt impulsi pomjeraju informaciju duž lanca. Upravo iz ovog razloga, ova kola se označavaju i kao CCD *shift* registri.



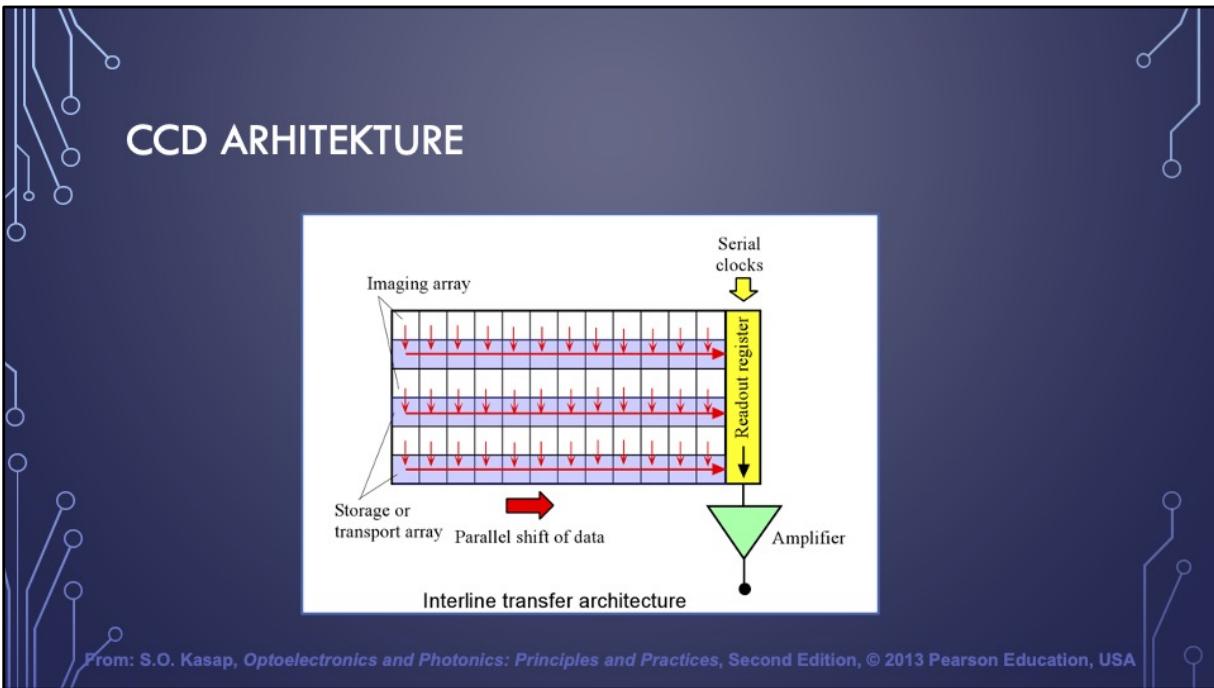
Postoje tri osnovna tipa CCD tehnika iščitavanja na osnovu kojih se razlikuju sljedeće CCD arhitekture:

- ***full frame***
- ***frame***
- ***interline transfer***

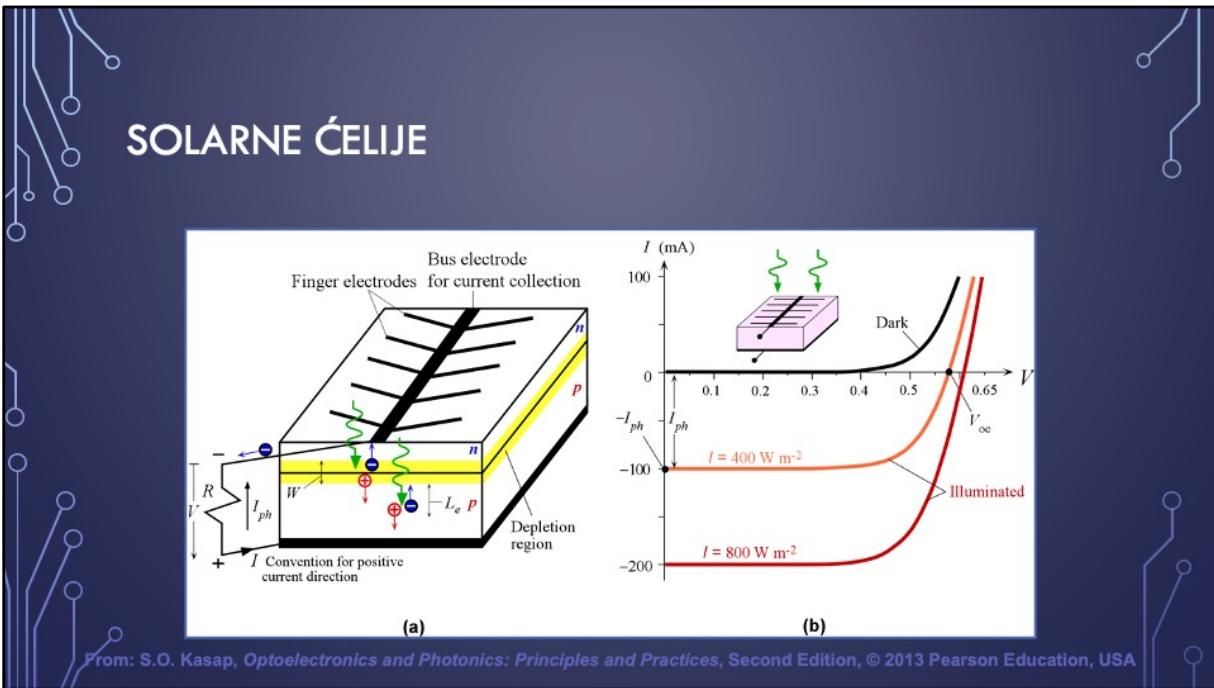
Kod *full-frame* arhitekture, senzor se sastoji od paralelnih CCD *shift* registara, serijskog CCD *shift* registra kao *read-out* registra i pojačavača, slika (a). Kolone podataka se vode prema serijskom registru, nakon projektovanja slike na niz, kada takt signal počne da prenosi nanelektrisanja sa piksela na piksel prema izlaznom *shift* registru. Proces traje dok se sve kolone podataka ne prenesu na izlaz. Ova arhitektura ima najveću rezoluciju. Nedostatak ove arhitekture je u tome što može doći do zamućenja slike uslijed „očitavanja“, dok istovremeno na senzor djeluje svjetlost. Iz tog razloga se uvode mehanički *shutter*-i, koji blokiraju svjetlost dok se obavlja pomjeranje i očitavanje nanelektrisanja. Mehanički *shutter*-i su spori i skloni oštećenjima. Ipak, ovu arhitekturu odlikuje visoka osjetljivost i mogućnost primjene u različitim uslovima osvijetljenosti.



*Frame* arhitektura, kako je prikazano na slici, je slična *full-frame* arhitekturi osim što se polovina niza koristi za skladištenje podataka kako bi se povećala brzina. Za *storage array* svjetlost je blokirana. Dakle, na ovaj način je izbjegnuta potreba za mehaničkim *shutter-ima*. Ideja je da se podaci pomjeraju od senzora veoma brzo kako bi se mogla snimiti sljedeća slika, što znači da je kod ove arhitekture postignuta veća brzina (*frame rate*), po cijenu redukovane rezolucije. U cilju povećanja rezolucije, potrebno je povećati površinu senzora, što znači i veću cijenu. Prilikom transporta nanelektrisanja od *imaging array* prema *storage array*, može doći do zamućenja slike.



*Interline transfer* arhitektura koristi svaki drugi red CCD niza za skladištenje i transport neposredno uz *imaging* niz kako je ilustrovano na slici. Prema transportnom redu svjetlost je blokirana, pa se podaci iz *imaging* reda paralelno prenose prema transport redu veoma brzo. Podaci se dalje pomjeraju duž transportnog reda prema izlazu. Na ovaj način gotovo da je eliminisan efekat zamućenja. Ipak, ukoliko je senzor izložen jakoj svjetlosti, može doći do „prelivanja“ nanelektrisanja ispod maske što opet odgovara zamućenju slike. Prednosti ove arhitekture su nizak nivo šuma i potpuna *stop-motion* kontrola kao posljedica simultanog transporta nanelektrisanja za sve piksele.



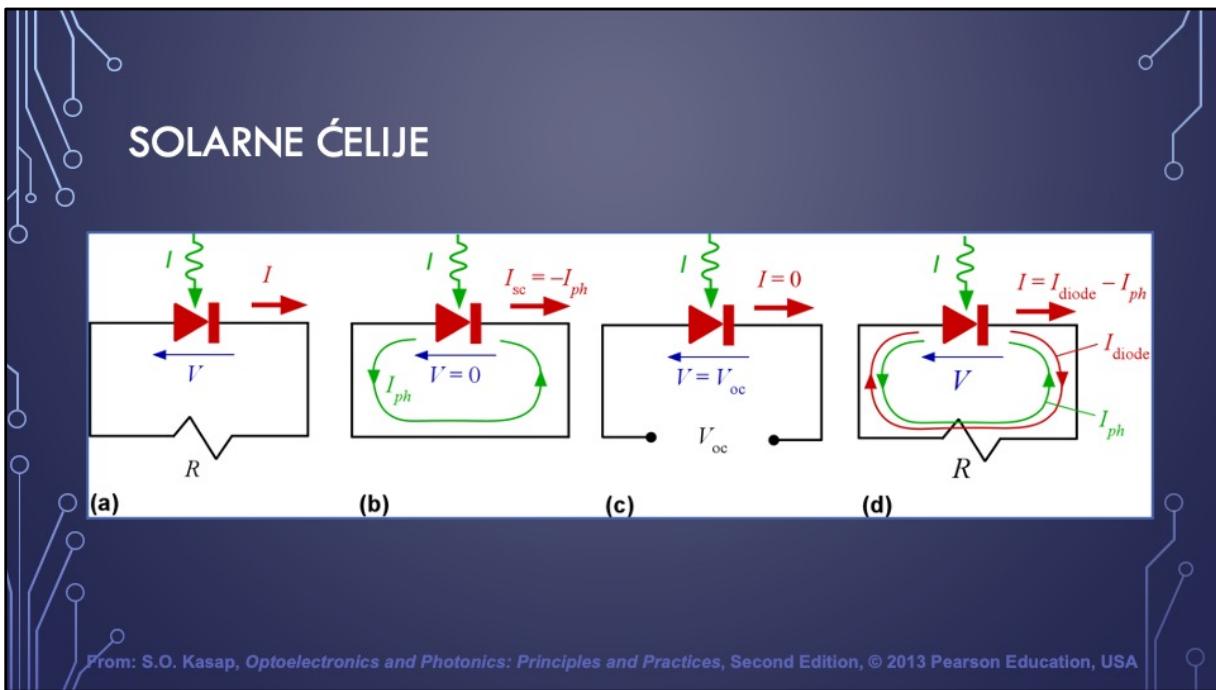
Solarne ćelije konvertuju energiju upadnog zračenja u električnu energiju. Apsorbovani fotoni fotogenerišu nosioce nanelektrisanja, koji potom "protiču" kroz spoljašnje opterećenje vršeći električni rad. Fotonaponski uređaji mogu biti bazirani na strukturi metal-poluprovodnik Schottky tipa, *pn* spoju, ili *pin* strukturi. Na primjer, Si *pn* solarna ćelija može sadržati tanki poluprovodnički sloj *n* tipa na debeloj podlozi *p* tipa, kako je prikazano na slici (a). Elektrode pričvršćene sa *n* strane moraju dozvoliti svjetlosti da „prodre“ u uređaj, a istovremeno moraju imati malu serijsku otpornost. Iz prethodnih razloga, elektrode se nanose na površinu *n* poluprovodnika u formi niza *finger* elektroda. Van elektroda postoji AR sloj u cilju redukovanja refleksije svjetlosti. *n* sloj *pn* spoja ima veoma malu debljinu kako bi se omogućila apsorpcija većine fotona u okviru osiromašene oblasti ili u okviru *p* strane. Fotogeneracija parova elektron-šupljina se dešava uglavnom u ovim oblastima. Kod silicijuma, difuziona dužina elektrona  $L_e$  je veća nego difuziona dužina šupljina  $L_h$ , što je i razlog formiranja strukture kod koje će se fotogeneracija dominantno odigravati (pored osiromašene oblasti) na *p* strani. Samo oni elektroni na *p* strani koji su na rastojanju manjem od  $L_e$  od oblasti prostornog tovara mogu doprinijeti fotostruji. Parovi elektron-šupljina fotogenerisani u oblasti širine  $W$ , slika (a), se razdvajaju i usmjeravaju pod uticajem polja. Elektroni *drift*-uju prema *n* strani dok šupljine *drift*-uju prema *p* strani, što rezultuje fotostrujom. Višak elektrona stiže do neutralne *n* oblasti, zatim preko

eksternog kola stiže do  $p$  strane gdje se rekombinuje sa viškom šupljina. Kao rezultat, postojaće kontinualna eksterna fotostruja sve dok je  $pn$  spoj osvijetljen. Važno je razumjeti da bez internog električnog polja ne bi bilo moguće usmjeriti nosioce nanelektrisanja, pa ne bi bilo ni struje u eksternom kolu.

Strujno naponska karakteristika tipične Si solarne ćelije je prikazana na slici (b). *Dark I-V* karakteristika odgovara karakteristici direktno polarisanog  $pn$  spoja. Pod uticajem svjetlosti, *dark I-V* karakteristika se translira prema dolje za iznos koji je jednak fotostruji  $I_{ph}$ . Fotostruja je proporcionalna intenzitetu upadne svjetlosti:

$$I_{ph} = KI$$

gdje je  $K$  specifična konstanta uređaja.



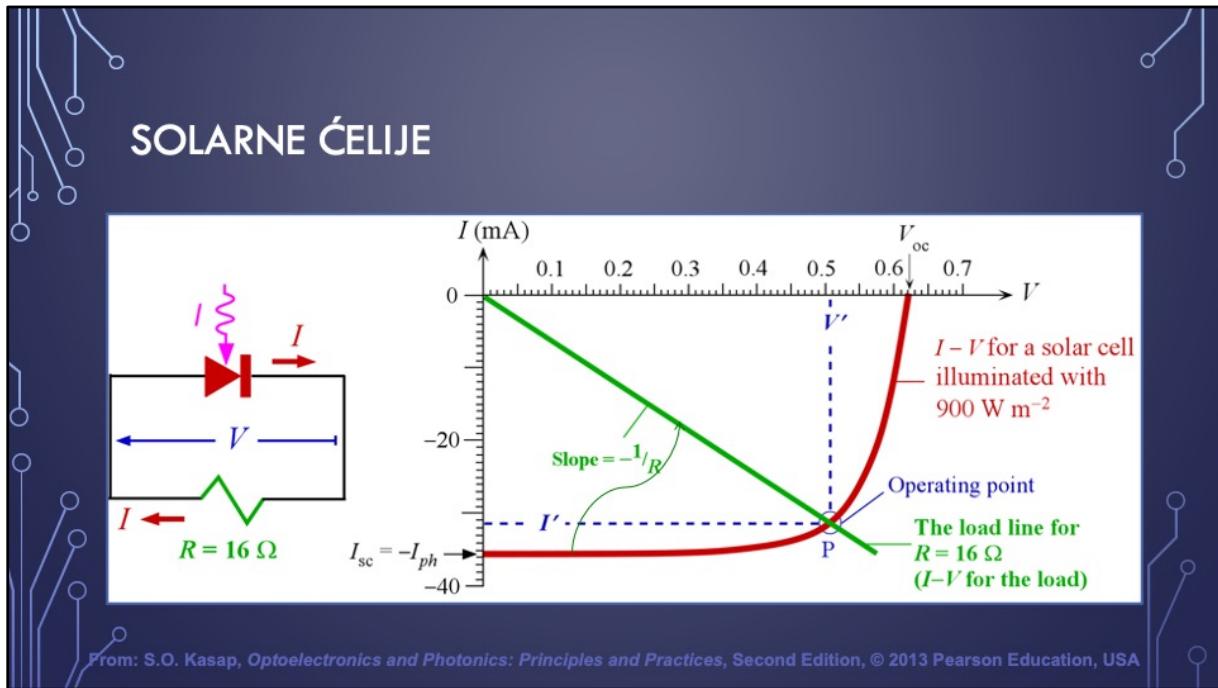
Kod kratko spojene solarne ćelije struja  $I_{sc} = -I_{ph}$ , i predstavlja važnu karakteristiku solarne ćelije, slika (b). Ukoliko je solarna ćelija u otvorenom kolu, eksterna struja je naravno jednaka 0, dok je napon otvorenog kola  $V_{oc}$ , slika (c). Ovaj napon odgovara tački presjeka  $I-V$  karakteristike sa  $V$ -osom. Fotogenerisani elektroni koji su usmjereni ka  $n$  strani ne mogu dalje, pa se nagomilavaju na  $n$  strani. Slično, fotogenerisane šupljine se nagomilavaju na  $p$  strani. Jasno je da postoji višak pozitivnog nanelektrisanja na  $p$  strani u odnosu na  $n$  stranu, odnosno da postoji pad napona. U stvarnosti, stvari su još malo složenije. Naime, višak elektrona na  $n$  strani neutralizuju neki od pozitivnih donorskih jona iz oblasti prostornog tovara. Višak šupljina neutralizuju neki od negativnih akceptorskih jona iz oblast prostornog tovara. Kao posljedica, interno električno polje slab, pa je samim tim i ugrađeni napon  $V_0$  redukovani. Zapravo, redukcija napona  $V_0$  se manifestuje kao napon na terminalima  $V_{oc}$ .

Prepostavimo da postoji eksterno opterećenje  $R$ , kako je prikazano na slikama (a) i (d). Eksterna struja (ne struja  $I_{ph}$ ) će teći kroz  $R$  i generisati pad napona  $V$  na krajevima opterećenja. Disipirana snaga na opterećenju iznosi  $IV$ . Očigledno bi bilo da je napon  $V$  na krajevima opterećenja  $R$  napon direktnе polarizacije  $pn$  spoja i da se kao posljedica ovog napona generiše struja  $I_{diode}$  (kao struja direktnо polarisanog  $pn$

spoja), čiji smjer je suprotan smjeru struje  $I_{ph}$ . Ukupna struja sada iznosi:

$$I = -I_{ph} + I_{diode}$$

Sa povećanjem intenziteta svjetlosti, povećava se struja  $I_{ph}$  i pomjera prema dolje strujno-naponsku karakteristiku diode.



Kada je opterećenje vezano za solarnu čeliju, slika (a), kroz opterećenje teče ista struja kao i kroz solarnu čeliju:

$$I = -\frac{V}{R}$$

Radna tačka kola ( $I'$ ,  $V'$ ) kola predstavlja presjek karakteristike diode i linije opterećenja.

Snaga isporučena potrošaču je  $P_{out} = I'V'$ . Maksimalna snaga se isporučuje potrošaču kada je površina pravougaonika ograničenog  $I$  i  $V$  osom maksimalna, što se ostvaruje promjenom otpornosti potrošača ili promjenom intenziteta svjetlosti, kada je  $I' = I_m$  i  $V' = V_m$ . *Fill faktor (FF)* koji predstavlja FOM (*Figure of Merit*) solarne čelije se definiše kao:

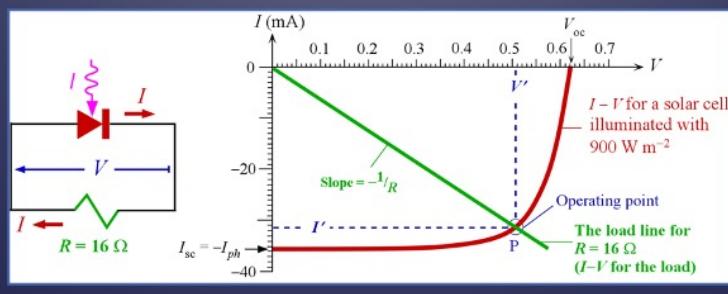
$$FF = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}}$$

FF je mjera koliko je  $I$ - $V$  kriva solarne čelije blizu pravougaonom (idealnom) obliku. Jasno je da je poželjno da FF vrijednost bude što bliža jedinici, što je naravno

ograničeno eksponencijalnom karakteristikom pn spoja. Tipično je FF vrijednost oko 70 % - 85 % u zavisnosti od strukture uređaja.

## SOLARNE ĆELIJE

*Primjer:* Posmatra se solarna ćelija za koju je povezano otporno opterećenje od  $16 \Omega$ . Pretpostavimo da solarna ćelija ima površinu  $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$  i da je osvjetljena svjetlošću intenziteta  $900 \text{ W/m}^2$ . Koliko iznose struja i napon u kolu? Kolika snaga je isporučena potrošaču? Koliko iznosi efikasnost solarne ćelije u kolu? Ukoliko se pretpostavi da solarna ćelija u režimu koji je blizak maksimalnoj isporučivoj snazi, koliko iznosi FF?

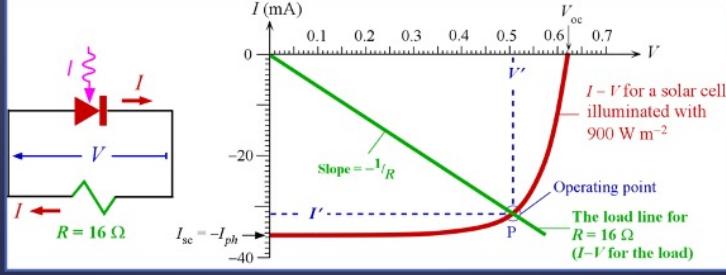


## SOLARNE ĆELIJE

*Rješenje:* Sa slike se može očitati približna vrijednost struje  $I' \approx -31.5 \text{ mA}$  i napona  $V' \approx 0.505 \text{ V}$ , što znači da je snaga isporučena potrošaču:

$$P_{out} = |I'V'| = 15.9 \text{ mW.}$$

Ovo nije obavezno i maksimalna snaga koja se može dobiti iz solarne ćelije.



## SOLARNE ĆELIJE

*Rješenje:*

*Snaga upadne svjetlosti:*

$$P_{in} = 900 \frac{W}{m^2} * 1 \text{ cm}^2 = 0.09 \text{ W.}$$

## SOLARNE ĆELIJE

*Rješenje:*

*Snaga upadne svjetlosti:*

$$P_{in} = 900 \frac{W}{m^2} * 1 \text{ cm}^2 = 0.09 \text{ W.}$$

*Efikasnost iznosi:*

$$100 * P_{out}/P_{in} = 17.7 \text{ %.}$$

## SOLARNE ĆELIJE

*Rješenje:*

**Snaga upadne svjetlosti:**

$$P_{in} = 900 \frac{W}{m^2} * 1 \text{ cm}^2 = 0.09 \text{ W.}$$

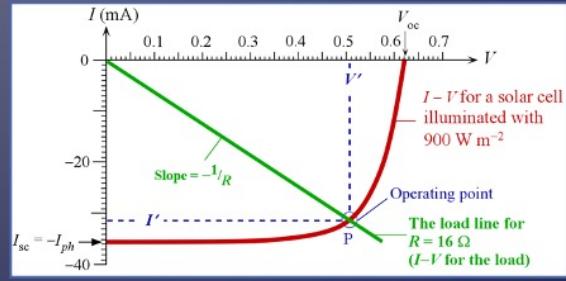
**Efikasnost iznosi:**

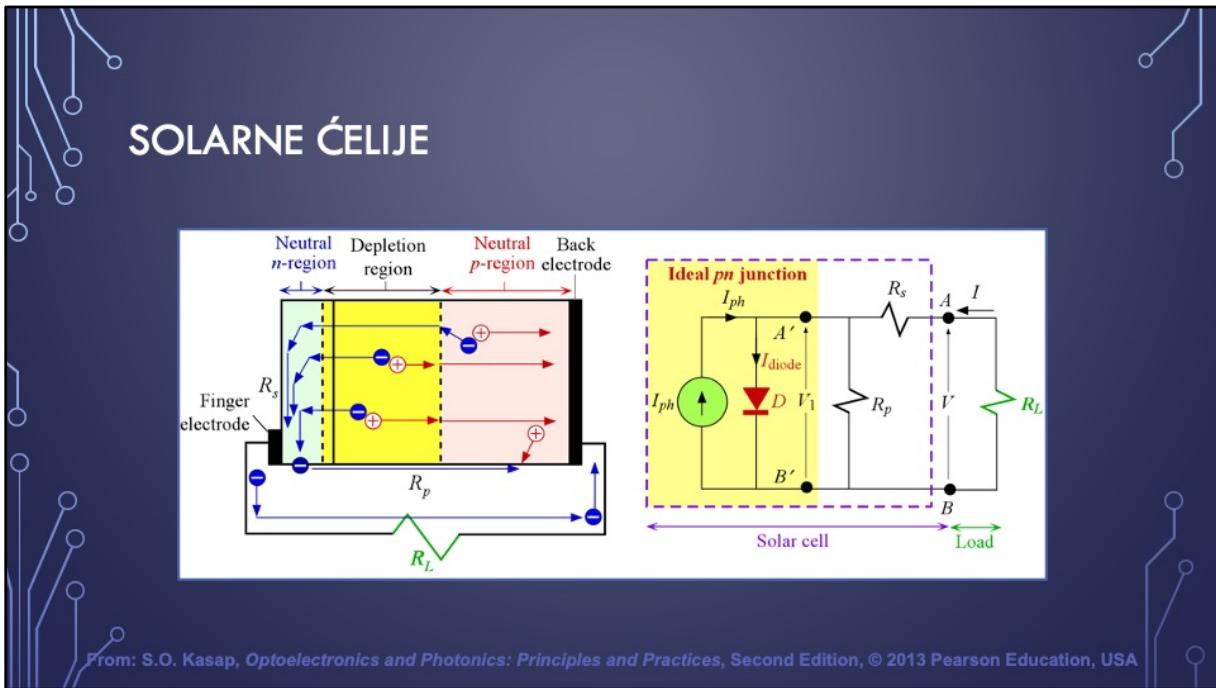
$$100 * P_{out}/P_{in} = 17.7 \text{ %.}$$

**FF se može izračunati kao:**

$$FF = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}} = 0.72,$$

pri čemu je  $I_{sc} = -35.5 \text{ mA}$ , dok je  $V_{oc} = 0.62 \text{ V}$ .





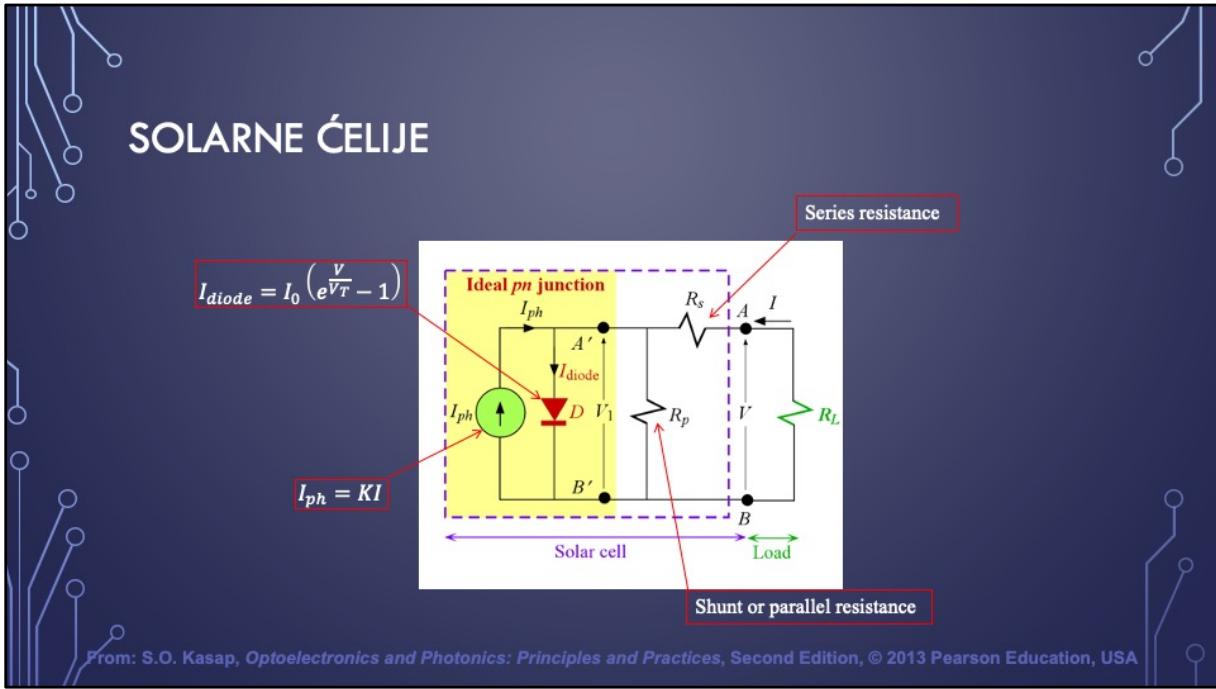
Solarne ćelije mogu značajno odstupati od idealizovanog prikaza solarne ćelije bazirane na *pn* spoju iz uvodnog dijela. Razmotrimo osvijetljenu solarnu ćeliju koja pobuđuje otporno opterećenje  $R_L$  i pretpostavimo da se fotogeneracija obavlja unutar osiromašene oblasti. Fotogenerisani elektroni treba da prelaze površinom poluprovodnika kao bi stigli do najbližeg "prsta" elektrode, slika (a). Putanje svakog od elektrona po površini *n* poluprovodnika uvode efektivnu serijsku otpornost  $R_s$  u fotonaponsko kolo. Takođe postoji i serijska otpornost od neutralne *p* oblasti, ali je ona generalno mala u odnosu na otpornost putanja elektrona do *finger* elektroda. Na slici (b) je prikazano ekvivalentno kolo solarne ćelije bazirane na *pn* spoju. Osjenčeni dio se odnosi na slučaj idealne *pn* diode. Proces fotogeneracije je predstavljen izvorom konstantne struje  $I_{ph}$ , koji generiše struju koja je proporcionalna intenzitetu svjetlosti. Tok fotogenerisanih nosilaca nanelektrisanja kroz spoj dovodi do povećanja napona  $V_1$  na spoju, i ovaj napon dovodi do struje diode  $I_{diode}$ . Struja  $I_{diode}$  je prikazana kao struja idealne diode D na slici (b). Napon  $V$  je napon koji se mjeri na izlaznim terminalima solarne ćelije:

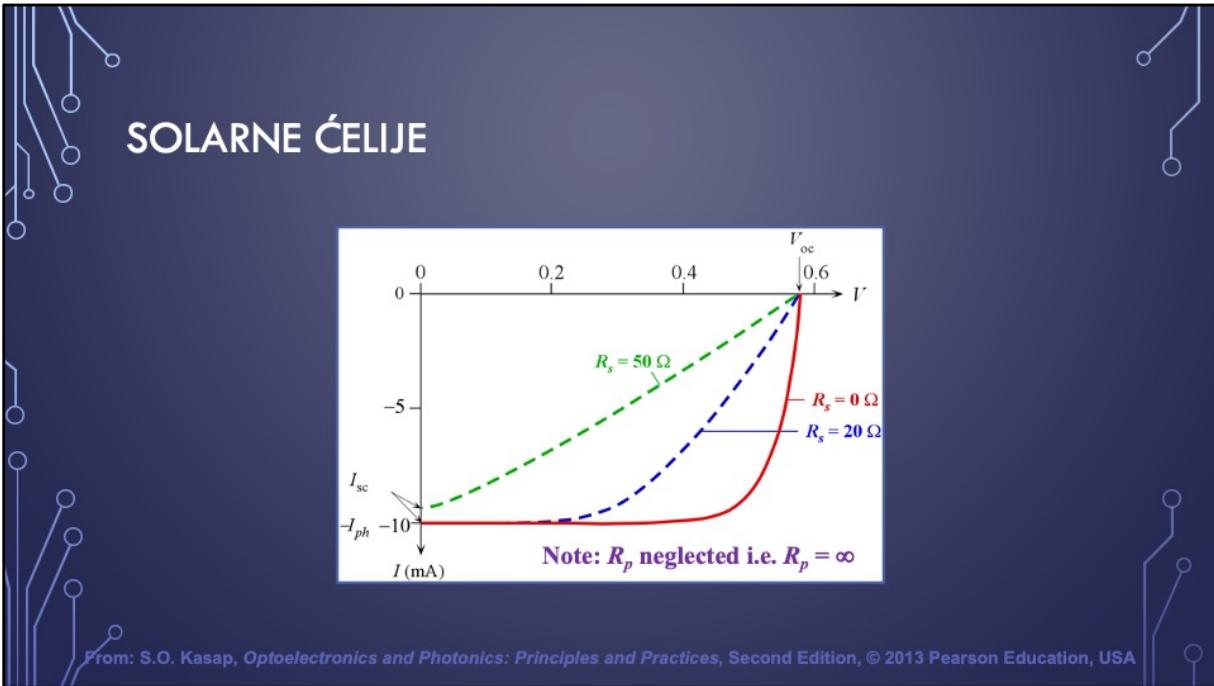
$$V = V_1 + R_s I$$

Ekvivalentno kolo prikazano na slici (b), van osjenčenog pravougaonika sadrži serijsku otpornost  $R_s$ , koja onemogućava "idealni" režim. Mali dio nanelektrisanja takođe može

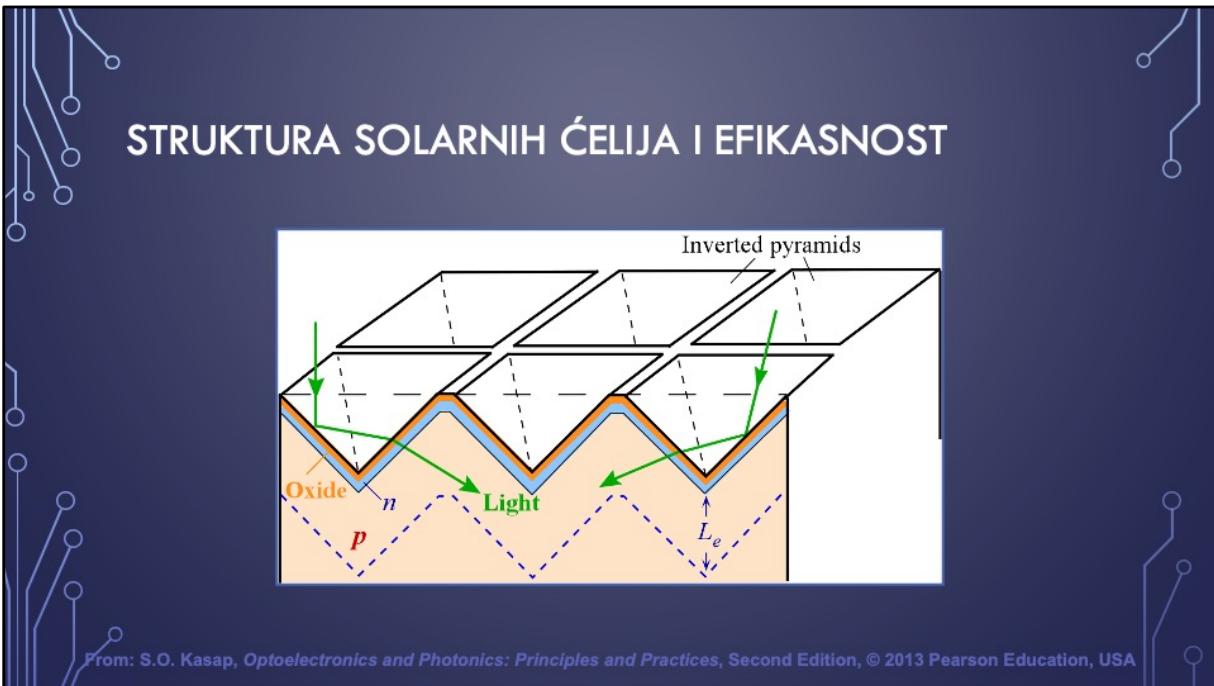
da teče kroz kristalnu površinu (ivicama uređaja), što se može predstaviti otpornošću  $R_p$ , paralelno idealnoj diodi. Obično  $R_p$  značajno manje utiče od  $R_s$  na vrijednost izlaznog napona solarne čelije.

## SOLARNE ĆELIJE





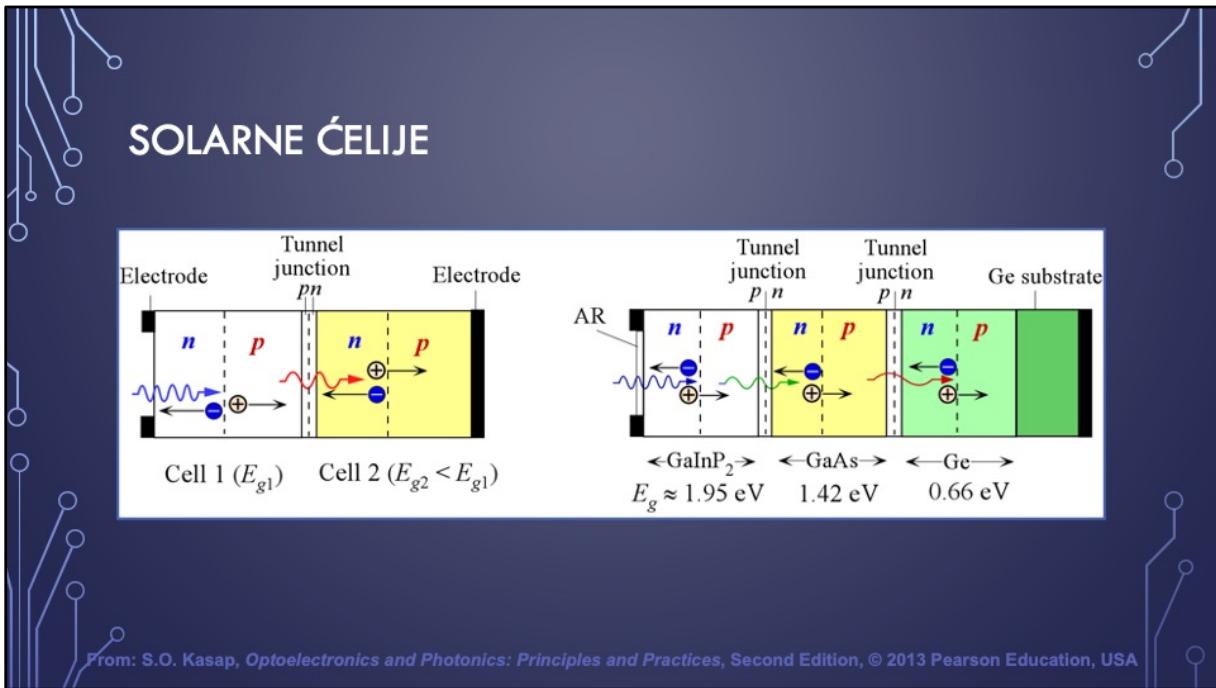
Serijska otpornost  $R_s$  može značajno da ugrozi performanse solarne ćelije, kako je prikazano na slici. Očigledno je da maksimalna dostupna snaga opada sa povećanjem otpornosti  $R_s$ , što znači da  $R_s$  redukuje efikasnost uređaja. Takođe se može uočiti da serijska otpornost ne utiče na napon  $V_{oc}$ .



Većina solarnih ćelija se bazira na kristalnom silicijumu kao najrasprostranjenijoj tehnologiji. Jedan od najvažnijih parametara solarnih ćelija je **efikasnost** koja se definije kao odnos maksimalne izlazne snage uređaja po jedinici snage upadnog zračenja pod definisanim uslovima. Spektar Sunčeve svjetlosti se razlikuje na različitim visinama u odnosu na površinu Zemlje zbog efekata apsorpcije i rasijanja u atmosferi, koji opet zavise od talasne dužine svjetlosti. Najčešće korišćen standard za poređenje solarnih ćelija je **AM1.5 solarni spektar** koji predstavlja Sunčevu zračenje koje stiže na površinu Zemlje sa integrisanim intenzitetom (za sve talasne dužine) od  $1000 \text{ W/m}^2$  na temperaturi od  $25^\circ\text{C}$ .

Tipične Si solarne ćelije imaju efikasnost od 18 % do 25 %. Refleksija svjetlosti sa površine solarne ćelije mora biti minimizovana, kako bi se povećala efikasnost. Najefikasnije među Si solarnim ćelijama su PERL (*Passivated Emitter Rear Locally diffused cells*) čiju površinu predstavljaju "invertovane" piramide, slika, kojima se "hvata" što je moguće više upadne svjetlosti. Uobičajena refleksija svjetlosti od ravne površine kristala dovodi do gubitaka svjetlosti, dok refleksije unutar piramida dozvoljavaju još nekoliko "dodatnih šansi" za refleksiju. Struktura je takva, da se nakon refrakcije svjetlosti foton nađe u zoni manjoj od difuzione dužine elektrona u odnosu na oblast prostornog tovara, slika. Značajni faktori koji redukuju efikasnost solarne ćelije su neapsorbovani fotoni čija je energija manja od  $E_g$  (velike talasne

dužine), kao i fotoni kratkih talasnih dužina koji se apsorbuju blizu površine. Ovi nedostaci se donekle prevazilaze upotrebom heterostruktura.



Jedna od efikasnih heterostruktura poznata je kao **tandem** solarna ćelija ili **multijunction** solarna ćelija. *Multijunction* solarne ćelije koriste dvije ili više ćelija u tandemu, ili kaskadno, kako bi se povećala apsorpcija fotona upadne svjetlosti, slika (a). Prva ćelija je napravljena od materijala sa širim energetskim procjepom i apsorbuje samo fotone energije veće od energije energetskog procjepa  $E_{g1}$ . Druga ćelija apsorbuje fotone koji prolaze kroz prvu ćeliju i imaju energiju veću od energije energetskog procjepa druge ćelije  $E_{g2}$ . Ćelije moraju biti povezane, kako bi nosioci najelektrisanja mogli da prolaze. Veza se ostvaruje korišćenjem visoko dopiranog veoma tankog *pn* spoja između dvije ćelije koji služi kao *tunneling* spoj. Svi slojevi se nanose specijalnim tehnikama rasta na jedinstvenoj podlozi. Veoma visoka efikasnost je postignuta troslojnom strukturom prikazanom na slici (b). Slojevi su formirani tehnikom rasta na podlozi od germanijuma i svaka ćelija je *np* spoj. Postoje dva veoma tanka tunelska spoja koji povezuju ćelije u tandemu kako je prikazano na slici (b), koji pospješuju prolazak nosilaca najelektrisanja. Gornja ćelija je od materijala čija je  $E_g \approx 1.95 \text{ eV}$  ( $\lambda_g = 0.64 \mu\text{m}$ ), druga  $E_g \approx 1.42 \text{ eV}$  ( $\lambda_g \approx 0.87 \mu\text{m}$ ) i treća  $E_g \approx 0.66 \text{ eV}$  ( $\lambda_g \approx 1.9 \mu\text{m}$ ). Tri ćelije imaju veoma širok spektralni opseg i u mogućnosti su da prihvate značajan procenat solarnog zračenja. Efikasnost prikazane ćelije je 29.5 %.

## SOLARNE ĆELIJE

*Primjer: Solarna ćelija osvijetljena svjetlošću intenziteta  $500 \text{ W/m}^2$  ima struju  $I_{sc} = -16 \text{ mA}$  i napon  $V_{oc} = 0.50 \text{ V}$ . Koliko iznosi struja kratkog spoja  $I_{sc}$  i napon otvorenog kola  $V_{oc}$  ukoliko se intenzitet upadne svjetlosti udvostruči.*



## SOLARNE ĆELIJE

Primjer: Solarna ćelija osvijetljena svjetlošću intenziteta  $500 \text{ W/m}^2$  ima struju  $I_{sc} = -16 \text{ mA}$  i napon  $V_{oc} = 0.50 \text{ V}$ . Koliko iznosi struja kratkog spoja  $I_{sc}$  i napon otvorenog kola  $V_{oc}$  ukoliko se intenzitet upadne svjetlosti udvostruči.

Rješenje: Kako struja kratkog spoja odgovara fotostruji, kada se intenzitet svjetlosti poveća dva puta, i struja će se povećati 2 puta. Dakle,  $I_{sc} = -32 \text{ mA}$ .

## SOLARNE ĆELIJE

Primjer: Solarna ćelija osvijetljena svjetlošću intenziteta  $500 \text{ W/m}^2$  ima struju  $I_{sc} = -16 \text{ mA}$  i napon  $V_{oc} = 0.50 \text{ V}$ . Koliko iznosi struja kratkog spoja  $I_{sc}$  i napon otvorenog kola  $V_{oc}$  ukoliko se intenzitet upadne svjetlosti udvostruči.

Rješenje: Kako struja kratkog spoja odgovara fotostruji, kada se intenzitet svjetlosti poveća dva puta, i struja će se povećati 2 puta. Dakle,  $I_{sc} = -32 \text{ mA}$ .

Strujno naponska karakteristika solarne ćelije ima sljedeći oblik:

$$I = -I_{ph} + I_0 \left( e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

## SOLARNE ĆELIJE

Primjer: Solarna ćelija osvijetljena svjetlošću intenziteta  $500 \text{ W/m}^2$  ima struju  $I_{sc} = -16 \text{ mA}$  i napon  $V_{oc} = 0.50 \text{ V}$ . Koliko iznosi struja kratkog spoja  $I_{sc}$  i napon otvorenog kola  $V_{oc}$  ukoliko se intenzitet upadne svjetlosti udvostruči.

Rješenje: Kako struja kratkog spoja odgovara fotostruji, kada se intenzitet svjetlosti poveća dva puta, i struja će se povećati 2 puta. Dakle,  $I_{sc} = -32 \text{ mA}$ .

Strujno naponska karakteristika solarne ćelije ima sljedeći oblik:

$$I = -I_{ph} + I_0 \left( e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

Za određivanje napona  $V_{oc}$  struju treba izjednačiti sa nulom. Ako se uzme u obzir da je  $V_{oc} \gg V_T$ , dobija se:  $V_{oc} = V_T \ln \left( \frac{I_{ph}}{I_0} \right)$ .

## SOLARNE ĆELIJE

$$V_{oc1} = V_T \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0}\right)$$

$$V_{oc2} = V_T \ln\left(\frac{2I_{ph}}{I_0}\right) = V_T \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0}\right) + V_T \ln 2 = V_{oc1} + V_T \ln 2 \approx 0.52 \text{ V}$$



## LITERATURA

- S. O. Kasap, *Optoelectronics and Photonics*, Pearson Education Limited, 2013
- John G. Webster, Halit Eren, *Measurements, Instrumentation, and Sensors Handbook, Electromagnetic, Optical, Radiation, Chemical, and Biomedical Measurements*, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2<sup>nd</sup> Edition, 2014
- Didier Decoster, Joseph Harari, *Optoelectronic Sensors*, Wiley, 2009.
- John P. Dakin, Robert G. W. Brown, *Handbook of Optoelectronics*, Taylor and Francis Group, 2006